

บทที่ 2

การใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นและทฤษฎีพื้นฐานที่สำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

1. กล่าวนำ

ปัจจุบัน วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อาจประกอบขึ้นจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเพียง 2-3 ตัวหรืออาจต้องใช้อุปกรณ์มากเป็น 2-3 ล้านตัว ก็ได้ การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยมือเปล่าอาจไม่สามารถทำได้เหมือนเช่นแต่ก่อนเพราะมีความยาก-ซับซ้อนและใช้เวลามาก กว่าจะได้คำตอบที่ต้องการ

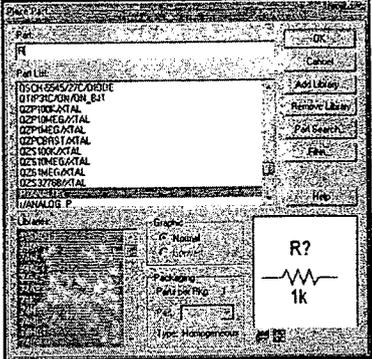
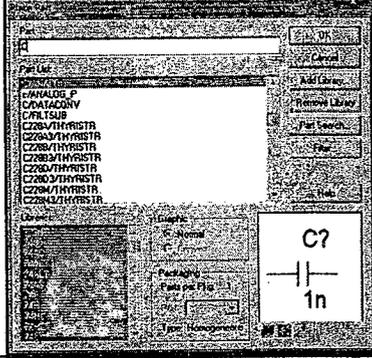
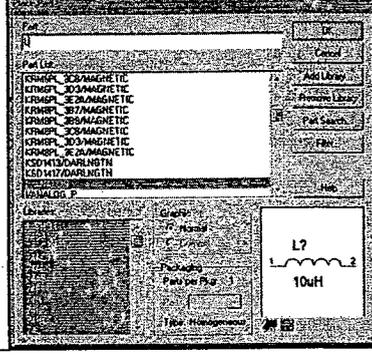
โปรแกรมจำลองการทำงาน (Simulation Program) ถูกพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงต้นปี ค.ศ. 1970s โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (University of California, Berkeley, USA) ในครั้งนั้นได้พัฒนาขึ้นด้วยภาษา FORTRAN ที่เป็นโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรม (main-frame computer) และตั้งชื่อโปรแกรมว่า SPICE ซึ่งย่อมาจาก Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis (SPICE) จากนั้นได้พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์วงจรพร้อมปรับเปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน SPICE2 อยู่ในรูปของ text editor นับจากนั้นเป็นต้นมาโปรแกรมก็มีถูกพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ เช่น โปรแกรม PSPICE ได้พัฒนาโดยบริษัท MicroSim Corporation ให้สามารถทำงานได้หลากหลายบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในปี 1984 (Personal Computer: PC) เครื่อง Macintoshes, และ Mini-computer เป็นต้น โดยเฉพาะที่พัฒนาบน PC เป็นโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ อีกทั้งมีเวอร์ชันสำหรับภาคการศึกษา (educational version) นับจากนั้นโปรแกรม PSPICE ก็ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย โปรแกรม PSPICE มีการแสดงผลเป็นกราฟ (graphical postprocessor: Probe) มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวงจรจาก text editor ซึ่งเป็นตัวหนังสือมากำหนดเป็นการเขียนวงจรแบบ graphical interface ที่เรียกว่า Schematic เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนวงจรและสะดวกต่อการตรวจสอบความถูกต้อง ด้วยความหลากหลายในการจำลองการทำงานทั้งวงจรแอนะล็อกและดิจิตอล บางครั้งอาจเรียกโปรแกรมนี้ว่า PSpice A/D จากนั้นพัฒนาเรื่อยมาจนถึงเวอร์ชัน 8 และถูกควบรวมกิจการโดย OrCAD พร้อมทั้งเปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน 9 ในนาม OrCAD PSpice A/D และมีการปรับปรุง Schematic โดยเรียกชื่อใหม่ว่า Schematic Capture จากนั้นก็ได้พัฒนาภายใต้ชื่อ OrCAD เวอร์ชันต่างๆ จนบริษัท CADENCE ได้เข้าซื้อกิจการพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น Cadence OrCAD ล่าสุดโปรแกรมได้ถูกพัฒนาเป็นเวอร์ชัน Cadence OrCAD16.6 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ (<http://www.cadence.com/products/orcad/pages/downloads.aspx>) นอกจากนี้ เรายังอาจพบ SPICE อยู่ในรูปทางการค้าอื่นๆ เช่น HSPICE และ B²SPICE เป็นต้น

การใช้โปรแกรมจำลองการทำงานมีข้อดีหลายอย่าง เช่น ช่วยหาคำตอบของกระแสที่ไหลผ่านอุปกรณ์ แรงดันที่ตำแหน่งต่างๆ หรือค่ากำลังงานที่เกิดขึ้นหรือที่สูญเสียในอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในวงจรได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้แล้ว เรายังสามารถใช้โปรแกรมช่วยจำลองการทำงานของอุปกรณ์หรือวงจรโดยการปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องกังวลความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์หรือวงจร ซึ่งต่างจากการต่อวงจรจริง อีกทั้ง การจำลองการทำงานสามารถช่วยยืนยันได้ว่าวงจรที่ออกแบบมีสมรรถนะเป็นตามที่ต้องการหรือไม่ อย่างไร หากไม่เป็นดังต้องการ เราสามารถปรับแก้ไขวงจรได้ ก่อนนำไปสร้างวงจรจริงและทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของวงจร

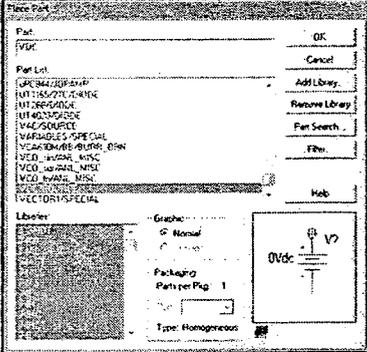
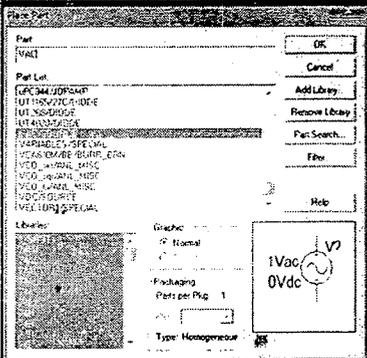
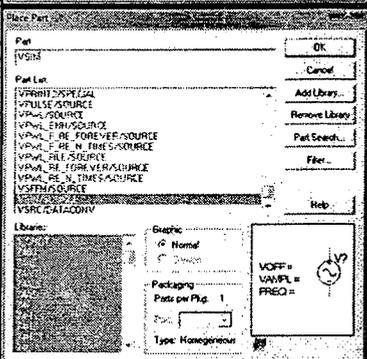
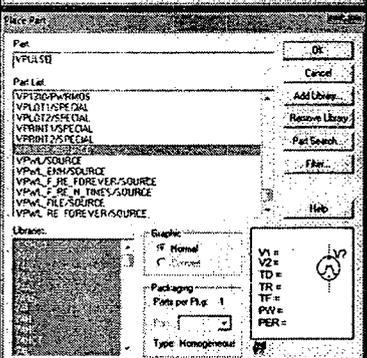
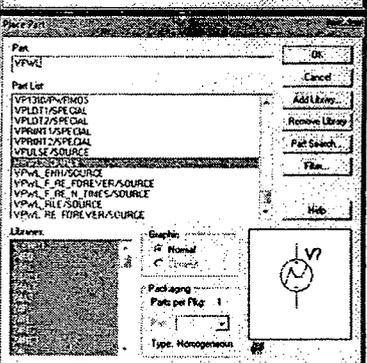
2. ข้อตกลงที่สำคัญและการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น

2.1 สัญลักษณ์ของอุปกรณ์

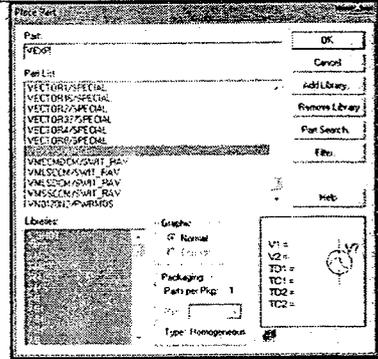
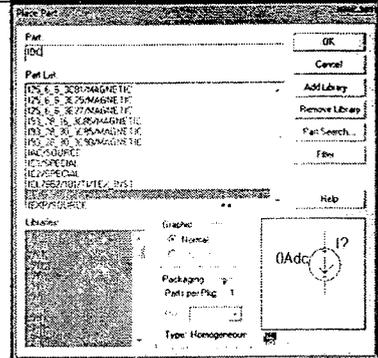
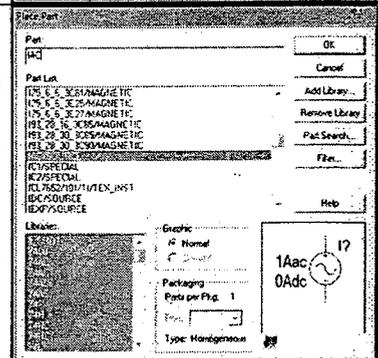
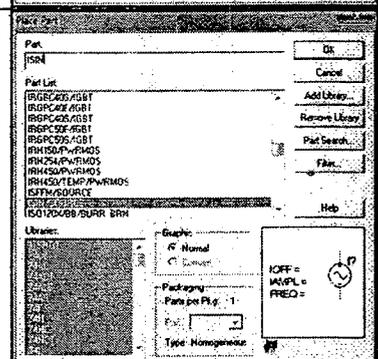
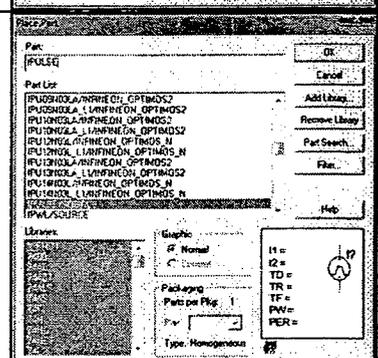
ตารางที่ 1 ตัวอย่างสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยในโปรแกรม

รายชื่ออุปกรณ์	ชื่อ Part	สัญลักษณ์
ตัวต้านทาน	R	
ตัวเก็บประจุ	C	
ตัวเหนี่ยวนำ	L	

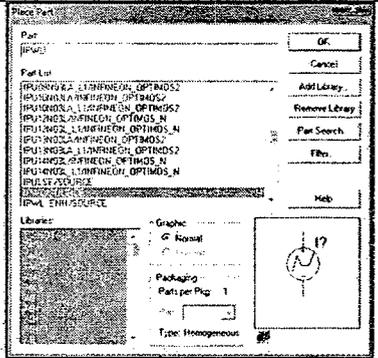
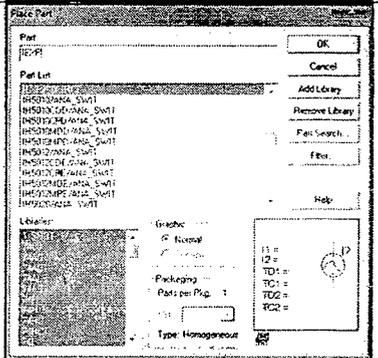
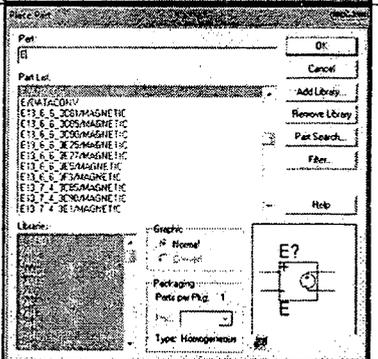
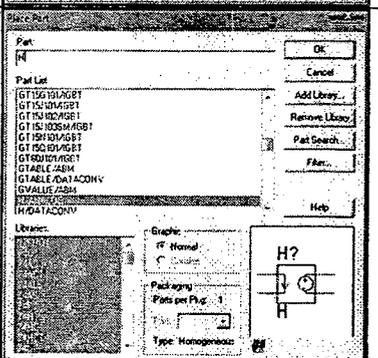
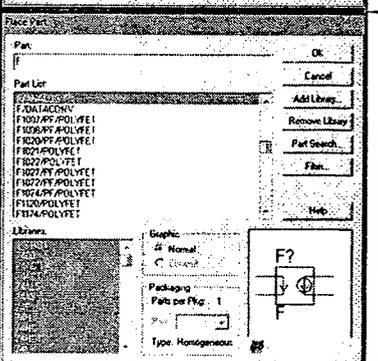
ตารางที่ 1 (ต่อ) ตัวอย่างสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยในโปรแกรม

แหล่งจ่ายแรงดันไฟตรง	Vdc	
แหล่งจ่ายแรงดันไฟสลับ	Vac	
แรงดันสัญญาณรูปไซน์	Vsin	
แรงดันสัญญาณรูปพัลส์	Vpulse	
แรงดันสัญญาณpiece wise linear	Vpwl	

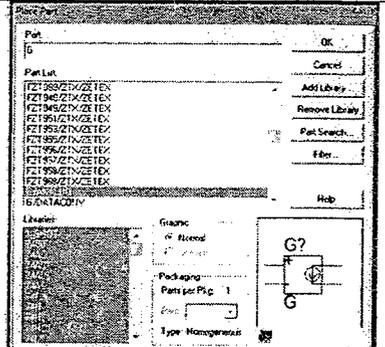
ตารางที่ 1 (ต่อ) ตัวอย่างสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยในโปรแกรม

<p>แรงดันสัญญาณเอ็กซ์โพเนนเชียล</p>	<p>Vexp</p>	
<p>แหล่งจ่ายกระแสไฟตรง</p>	<p>Idc</p>	
<p>แหล่งจ่ายกระแสไฟสลับ</p>	<p>Iac</p>	
<p>กระแสสัญญาณรูปไซน์</p>	<p>I sin</p>	
<p>กระแสสัญญาณรูปพัลส์</p>	<p>I pulse</p>	

ตารางที่ 1 (ต่อ) ตัวอย่างสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยในโปรแกรม

<p>กระแสสัญญาณ piece wise linear</p>	<p>lpwl</p>	
<p>กระแสสัญญาณเอ็กซ์โพเนนเชียล</p>	<p>lexp</p>	
<p>แหล่งจ่ายแรงดันที่ถูกควบคุมด้วยแรงดัน</p>	<p>Voltage controlled voltage source: E</p>	
<p>แหล่งจ่ายแรงดันที่ถูกควบคุมด้วยกระแส</p>	<p>Current controlled voltage source: H</p>	
<p>แหล่งจ่ายกระแสที่ถูกควบคุมด้วยกระแส</p>	<p>Current controlled current source: F</p>	

ตารางที่ 1 (ต่อ) ตัวอย่างสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยในโปรแกรม

แหล่งจ่ายกระแสที่ถูกควบคุมด้วยแรงดัน	Voltage controlled current source: G	
--------------------------------------	--------------------------------------	--

2.2 หน่วยที่มาตรฐานที่ใช้

ตารางที่ 2 ตัวอย่างหน่วยมาตรฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ใช้บ่อยในโปรแกรม

ชื่อหน่วย	ค่า	ตัวแปรที่ใช้
เฟมโต (femto)	1E-15	f
พิโค (pico)	1E-12	p
นาโน (nano)	1E-9	n
ไมโคร (micro)	1E-6	u
มิลลิ (milli)	1E-3	m
กิโล (kilo)	1E+3	K
เมกกะ (mega)	1E+6	MEG
กิกะ (giga)	1E+9	G
เทอร่า (tera)	1E+12	T

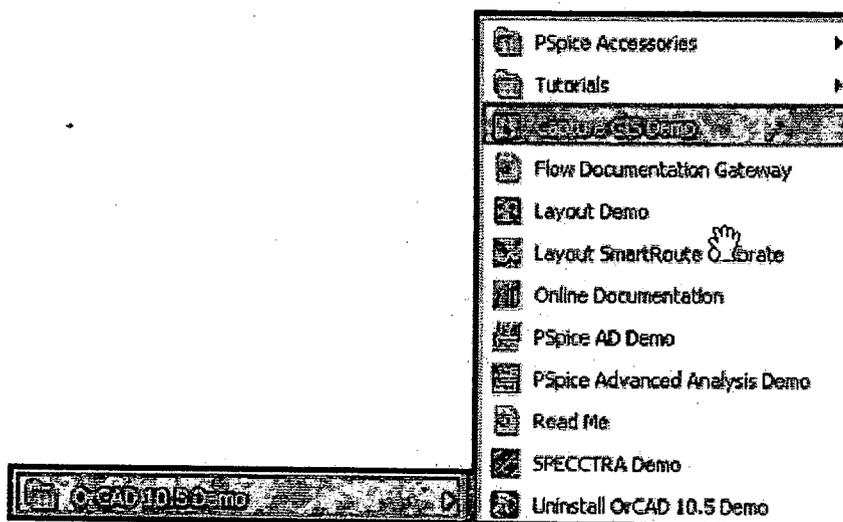
2.3 ข้อห้ามและข้อจำกัดของเวอร์ชันทดลองใช้

- ชื่อของตัวต้านทานที่ใช้ต้องขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัว R เท่านั้น
- ชื่อของตัวเก็บประจุที่ใช้ต้องขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัว C เท่านั้น
- ชื่อของตัวเหนี่ยวนำที่ใช้ต้องขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัว L เท่านั้น
- ชื่อของแหล่งจ่ายแรงดันแบบอิสระ (independent voltage source) ที่ใช้ต้องขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัว V เท่านั้น
- ชื่อของแหล่งจ่ายกระแสแบบอิสระ (independent current source) ที่ใช้ต้องขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัว I เท่านั้น
- พยัญชนะตัวเล็กกับตัวใหญ่มีค่าและความหมายเหมือนกัน

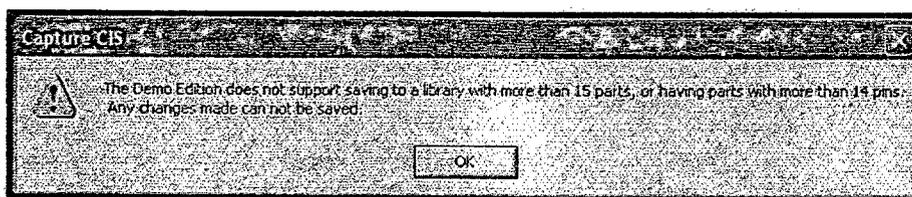
- การใช้ตัวพยัญชนะห้ามมีการเว้นวรรค ห้ามใช้เครื่องหมายติงศกัณฑ์ (hyphen) แต่สามารถใช้เครื่องหมายขีดกลางได้ (underscore)
- ห้ามใช้เครื่องหมายขีดกลางขึ้นหน้าพยัญชนะ
- ห้ามใช้เครื่องหมาย # (number sign)
- การต่อวงจรในการจำลองแต่ละครั้งมีจำนวนโหนดไม่เกิน 64 โหนด
- ออปแอมป์ใช้งานได้ไม่เกิน 2 ตัว
- ทรานซิสเตอร์ใช้งานได้ไม่เกิน 10 ตัว
- สายนำสัญญาณทั้งแบบอุดมคติและแบบไม่เป็นอุดมคติใช้งานรวมกันได้ไม่เกิน 10 เส้น
- อุปกรณ์ดิจิทัลแบบดั้งเดิมใช้งานรวมกันได้ไม่เกิน 65 ตัว
- ไลบรารีของอุปกรณ์แอนะล็อกมีจำนวน 39 ไลบรารี
- ไลบรารีของอุปกรณ์ดิจิทัลมีจำนวน 134 ไลบรารี
- ถ้าอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาด schematic ไม่เกิน 15 parts สามารถบันทึก (save) ไฟล์ได้ ในทางตรงข้าม เราสามารถที่จะวาดอุปกรณ์มากกว่านั้นได้ แต่จะไม่สามารถบันทึกไฟล์ได้

2.4 การเรียกใช้โปรแกรมและการใช้งานเมนูย่อย

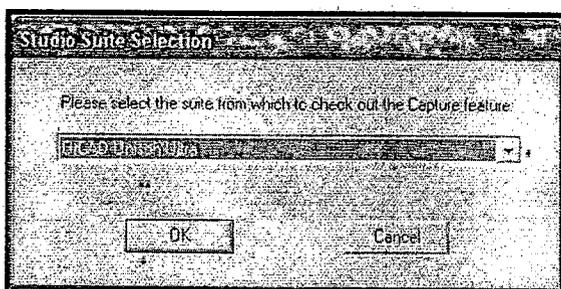
- ขั้นตอนการเรียกใช้โปรแกรม
- n) Start->OrCAD 10.5->Capture CIS Demo



จากนั้นจะแสดงข้อจำกัดของเวอร์ชันสาธิต (demo version)

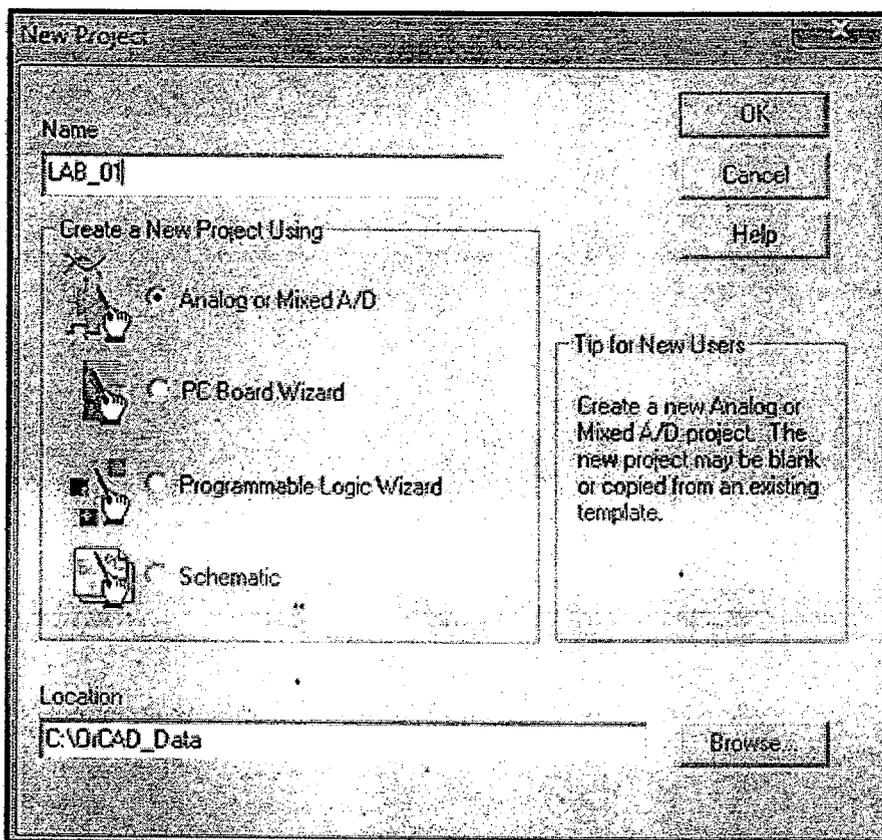


จากนั้นจะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา ให้เลือกค่าตามรูปข้างล่าง

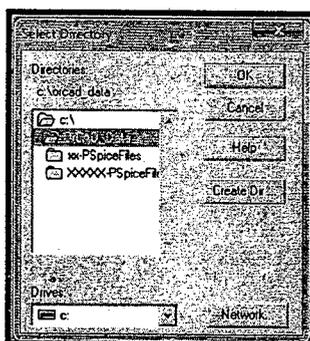


จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง OrCAD Capture

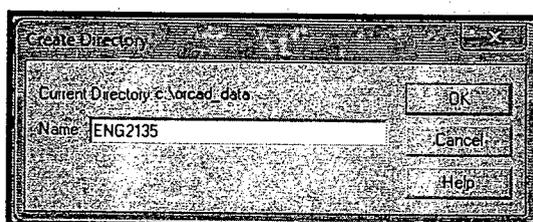
- ข) เลือก File->New->Project พร้อมกับตั้งชื่อ File เช่น LAB_01
- ค) คลิกเลือกช่อง Analog or Mixed A/D พร้อมกับเลือก Location เป็นไดร์ฟที่ต้องการบันทึกไฟล์

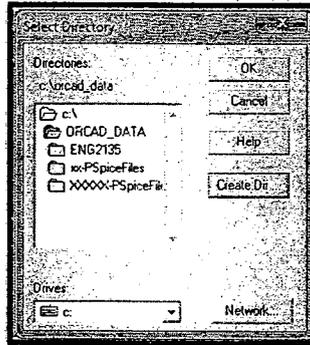


เลือก Browse ไปยังไดรฟ์ที่ต้องการบันทึก



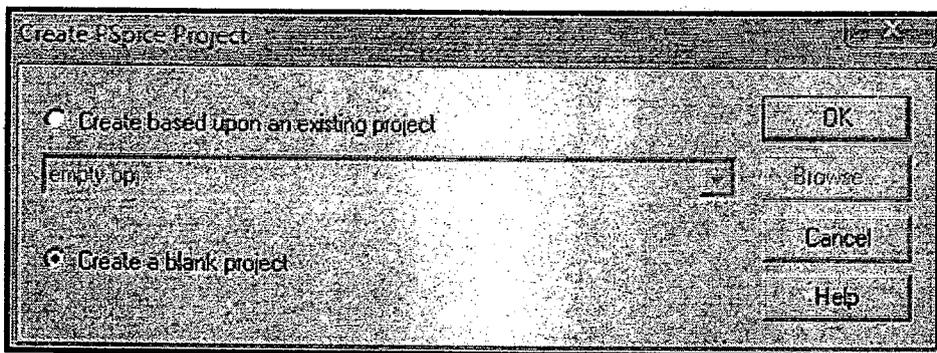
หรือถ้าต้องการสร้างไดเรกทอรีใหม่ก็เลือก Create Dir... พิมพ์ชื่อไดเรกทอรีที่ต้องการสร้าง เช่น ENG2135 จากนั้นกด OK



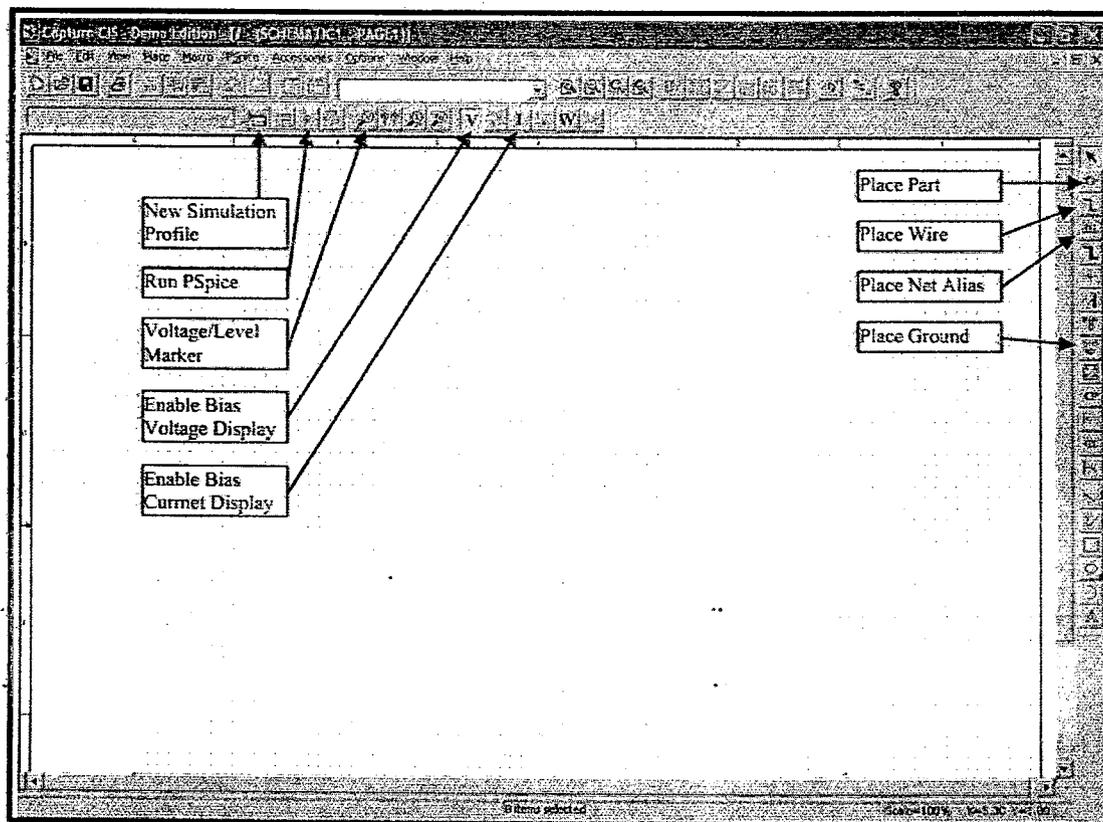


ดับเบิลคลิกที่ไดเรกทอรี ENG2135 เพื่อเลือกไดเรกทอรีที่ใช้งานที่เคยสร้างไว้ จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อกลับไปยังหน้าต่าง New Project จากนั้นเลือก OK เพื่อสร้าง New Project

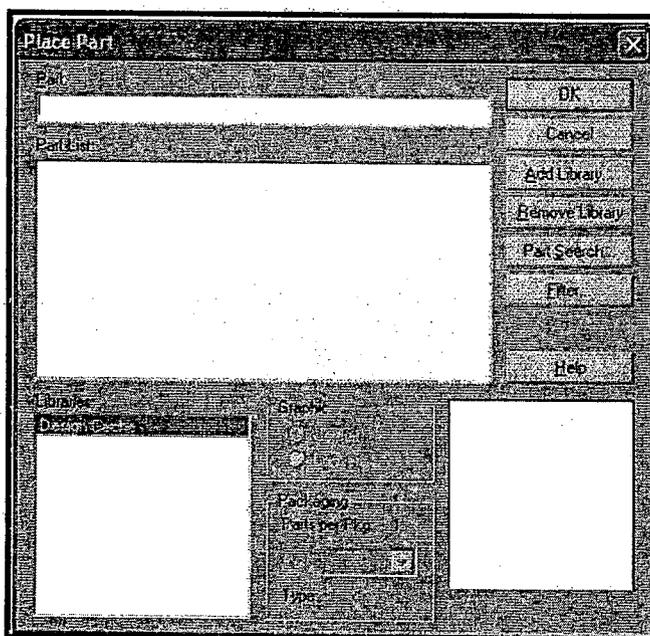
เลือก Create a blank project เพื่อเปิดหน้าต่างที่เป็น Schematic ที่ว่างเปล่า



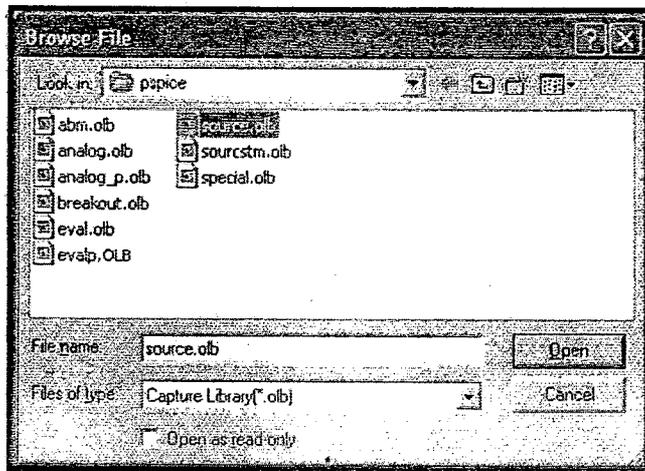
ตัวอย่างของหน้าต่าง Schematic ที่ว่างเปล่า



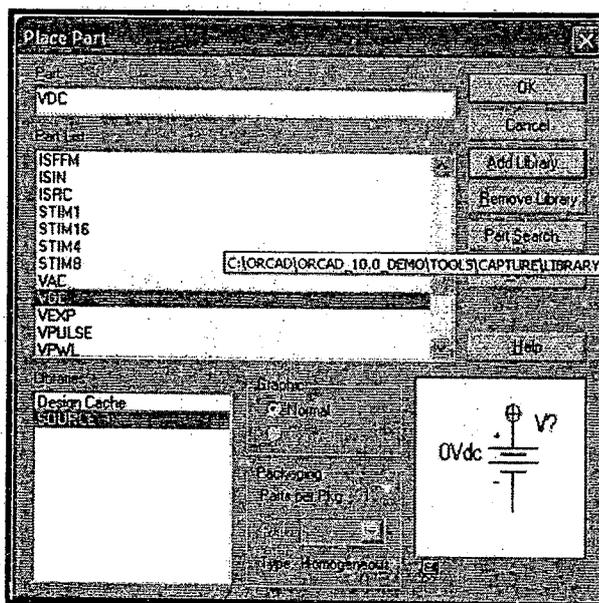
หลังจากที่หน้าต่าง Schematic ถูกเปิดขึ้นมา การวางอุปกรณ์ทำได้โดยเลือกคดปุ่มที่ 2 ทางด้านขวามือในแนวตั้งแล้ว จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา



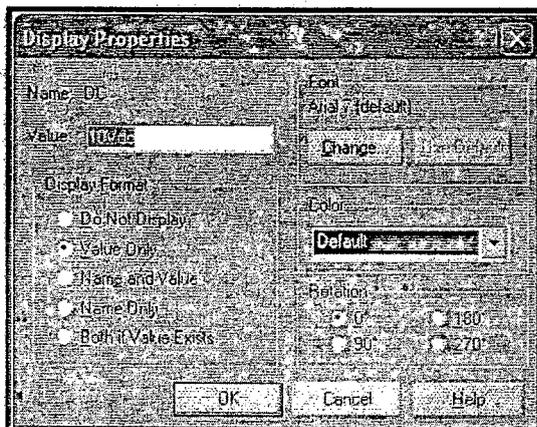
ง) กดปุ่ม Add Library เพื่อเพิ่มไลบรารี



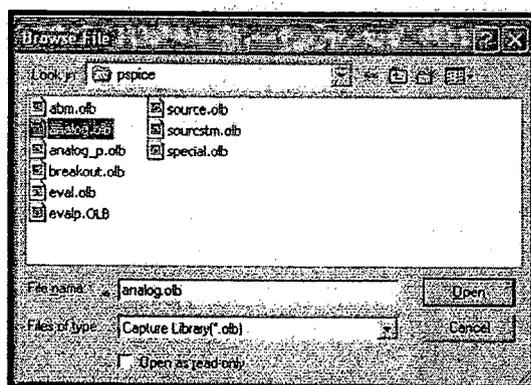
- จ) เลือก High Light บรรทัด source.olb แล้วกดปุ่ม Open
- ฉ) จากนั้นกดปุ่มที่ 2 ในแนวตั้งทางด้านขวามือเพื่อวางอุปกรณ์ เช่น ถ้าเป็นแหล่งจ่ายไฟตรง ให้เลือก High Light ที่มุมซ้ายด้านล่างของ Libraries เป็น SOURCE
- ช) ส่วนช่อง Part ซึ่งอยู่มุมบนด้านขวามือให้พิมพ์ VDC ตามรูป โดยสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ที่พิมพ์ลงในหน้าต่างนี้จะปรากฏให้เห็นในมุมล่างด้านขวามือให้นักศึกษาตรวจสอบว่าตรงกับที่ต้องการเลือกใช้หรือไม่ ถ้าตรงก็กด OK ถ้าไม่ตรงให้ตรวจสอบใหม่ พร้อมทั้งแก้ไขให้ถูกต้อง



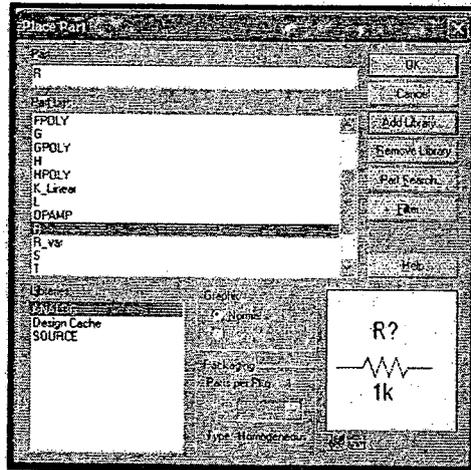
- ข) จากนั้นวางอุปกรณ์ลงบน Blank Schematic การแก้ไขค่าแรงดัน VDC ทำได้ด้วยการดับเบิลคลิกที่ค่าประจำตัวของอุปกรณ์เช่น จาก 0 โวลต์ เป็นค่า 10 โวลต์ หรือ ดับเบิลคลิกที่ตัวอุปกรณ์ จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมา พร้อมกับให้แก้ไขค่าในช่อง Value เช่น 10V นอกจากนี้ เรายังเลือกรูปแบบการแสดงค่า ขนาดและรูปแบบของตัวอักษร สีและลักษณะการวางอุปกรณ์ในหน้าต่างนี้ได้ด้วย



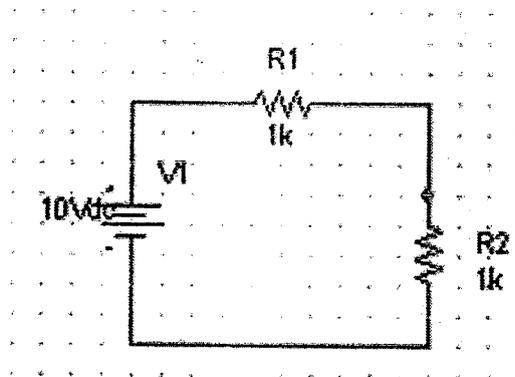
- ฅ) จากนั้นกดปุ่ม ESC เพื่อเสร็จสิ้นการวางอุปกรณ์ (ยกเลิกคำสั่งทั้งหมด)
 ฉ) หากต้องการวางตัวต้านทานทำได้โดยเพิ่มไลบรารี analog.olb ด้วยการ Add Library พร้อมกับเลือก High Light บรรทัด analog.olb แล้วกดปุ่ม Open



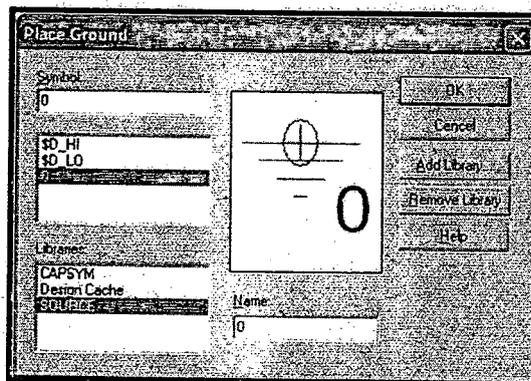
- ฎ) เมื่อกดปุ่มที่ 2 ในแนวตั้งซึ่งอยู่ทางด้านขวามือ จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา จากนั้นที่มุมล่างด้านซ้ายมือให้เลือก Libraries ที่ชื่อ ANALOG ส่วนมุมบนด้านซ้ายมือในช่อง Part ให้พิมพ์ R จะได้ดังรูป



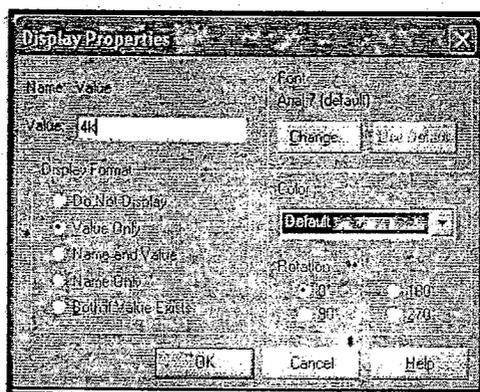
- ฎ) จากนั้นกดปุ่ม OK
- ฐ) ในการวางตัวต้านทานตัวที่ 2 ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันกับขั้นตอนที่ผ่านมา หากต้องการปรับตัวต้านทานที่วางในแนวนอนให้เป็นการวางในแนวตั้ง สามารถทำได้โดยเลือกที่แถบเมนูด้านบนสุด จากนั้นเลือก Edit และเลือก Rotate ตามลำดับ
- ฑ) จากนั้นวาดเส้นเชื่อมต่อวงจรโดยกดปุ่มที่ 3 ในแนวตั้งทางด้านขวามือ ลากเส้นเชื่อมต่อวงจรตามต้องการ ดังรูป



- ฒ) การต่อกราวด์ให้กับวงจรทำได้ด้วยการกดปุ่มที่ 9 ในแนวตั้งทางขวามือ จะมีหน้าต่างปรากฏตามรูป



- ณ) ให้เลือกช่อง Libraries เป็น SOURCE ส่วนช่อง Symbol พิมพ์ 0 จากนั้นกดปุ่ม OK ราสัญลักษณ์กราวด์ที่ได้ไปต่อในตำแหน่งที่ต้องการ พร้อมกับลากเส้นโดยการกดปุ่มที่ 3 เพื่อเชื่อมต่อกราวด์เข้ากับวงจรให้ถูกต้อง
- ด) ส่วนการปรับเปลี่ยนค่าความต้านทานสามารถทำได้โดยการดับเบิลคลิกที่ค่าของตัวต้านทานที่ต้องการเปลี่ยน เช่น การเปลี่ยนความต้านทานจาก 1k เป็น 4k จะเป็นดังรูป



3. ทฤษฎีพื้นฐานที่สำคัญ

3.1 ไดโอด

ไดโอดจัดเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งในวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากทั้งในอดีตและปัจจุบัน คุณสมบัติที่สำคัญของไดโอดคือความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันที่ตกคร่อมตัวไดโอดและกระแสจะไม่เป็นเชิงเส้น

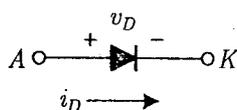
ไดโอดเป็นอุปกรณ์ประเภท 2 ขั้ว ประกอบขึ้นจากสารกึ่งตัวนำชนิดพี (P-type) และสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น (N-Type) ต่อเชื่อมเข้าหากัน เราเรียกไดโอดแบบนี้ว่า “ไดโอดรอยต่อ (Junction Diode)” แต่ในทางปฏิบัติ เราไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยตรงเพราะจะเกิดปัญหาหลายอย่างที่ไม่สามารถคาดคะเนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นในทางปฏิบัติ บริเวณรอยต่อเราจะสร้างขึ้นโดยอาศัยการแพร่สารเจือ หมู่ III ลงไปในสารเจือชนิดเอ็น หรือแพร่สารเจือ หมู่ V ลงไปในสารกึ่งตัวนำชนิดพี

เนื่องจากอิเล็กตรอนเป็นพาหะส่วนใหญ่ (majority carrier) ในสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น ขณะที่สารกึ่งตัวนำชนิดพีมีโฮลเป็นพาหะส่วนใหญ่ ผลที่ได้คือ อิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็นจะแพร่เข้าสู่บริเวณสารกึ่งตัวนำชนิดพี แล้วไปรวมตัวกับโฮลที่อยู่ในสารกึ่งตัวนำชนิดพีซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งในทางกลับกัน โฮลในสารกึ่งตัวนำชนิดพี ก็จะแพร่เข้าสู่บริเวณสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็นทำให้เกิดการรวมตัวกับอิเล็กตรอนอิสระในสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น

การแพร่ที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งอนุภาคมีความหนาแน่นเสมอกันทั่วทุกบริเวณ แต่การแพร่ของอิเล็กตรอนและโฮลจะแตกต่างกัน กล่าวคือ ในช่วงแรกๆ จะเกิดการ

แพร่อย่างรวดเร็วมาก และการแพร่จะค่อยๆ ช้าลงเมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้น จนกระทั่ง ณ สภาวะสมดุล จะไม่เกิดการแพร่ (หรือเกิดขึ้นเพียงน้อยมาก) มีเพียงบริเวณรอยต่อเท่านั้นที่ไม่เกิดการแพร่ขึ้นเลย และเรียกบริเวณรอยต่อนี้ว่า บริเวณปลอดพาหะ (depletion region) มีเพียงประจุไฟฟ้าสถิตย์ที่เป็นอ็อนบวกและอ็อนลบเท่านั้น

ประจุไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปในลักษณะที่ด้านการเคลื่อนที่ของพาหะข้ามรอยต่อ (ประจุบวกสถิตย์ในบริเวณปลอดพาหะฝั่งสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็นจะต้านไม่ให้โฮลในฝั่งสารกึ่งตัวนำชนิดพีข้ามรอยต่อมา รวมไปถึง ประจุลบสถิตย์ที่เกิดขึ้นในบริเวณปลอดพาหะฝั่งสารกึ่งตัวนำชนิดพีจะต้านไม่ให้อิเล็กตรอนอิสระในฝั่งสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็นข้ามรอยต่อมา เช่นกัน) แสดงว่าความกว้างของบริเวณปลอดพาหะจะเป็นตัวคอยป้องกันไม่ให้โฮลและอิเล็กตรอนอิสระข้ามรอยต่อไปมาได้อย่างสะดวกและเป็นตัวกำหนดศักย์ภายใน (built-in potential) มีค่าแปรตามความเข้มข้นของพาหะในสารกึ่งตัวนำ เมื่อนำไปใช้งานในวงจรไฟฟ้าจะต้องต่อขั้วไฟฟ้าออกมาข้างนอก โดยขั้วไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับสารกึ่งตัวนำชนิดพีเรียกว่า ขั้วแอนอด (Anode: A) อีกขั้วไฟฟ้าที่ต่อกับสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็นเรียกว่า ขั้วคาโทด (Cathode: K) สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าของไดโอดแสดงได้ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 สัญลักษณ์ของไดโอดในวงจรไฟฟ้า

3.2 คุณสมบัติทางไฟตรง

เมื่อไดโอดรอยต่อได้รับแรงดันไฟฟ้าจากภายนอกโดยให้ขั้วแอนอดมีแรงดันสูงกว่าขั้วคาโทด จะทำให้โฮลที่มีอยู่ในสารกึ่งตัวนำชนิดพี จะถูกดึงดูดโดยขั้วลบจากแรงดันไฟฟ้าจากภายนอก ในขณะที่เดียวกันอิเล็กตรอนอิสระที่มีอยู่ในสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น ก็จะถูกดึงดูดโดยขั้วบวกไฟฟ้าจากแรงดันภายนอกเช่นกัน การเคลื่อนที่ของพาหะดังกล่าวจะทำให้บริเวณปลอดพาหะแคบลง ส่งผลให้การแพร่ของอิเล็กตรอนอิสระและโฮลข้ามรอยต่อได้มากขึ้น เราเรียกการไบอัสแบบนี้ว่า “การไบอัสไปข้างหน้า (forward bias)” หรือบางทีอาจเรียกว่า “ไบอัสตรง”

ในทางตรงข้าม หากให้ไดโอดรอยต่อได้รับแรงดันไฟฟ้าจากภายนอก โดยให้ขั้วแอนอดมีแรงดันต่ำกว่าขั้วคาโทดแล้ว จะทำให้โฮลที่มีอยู่ในสารกึ่งตัวนำชนิดพี จะถูกดึงดูดโดยขั้วลบจากแรงดันไฟฟ้าจากภายนอก ในขณะที่เดียวกันอิเล็กตรอนอิสระที่มีอยู่ในสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น ก็จะถูกดึงดูดโดยขั้วบวกไฟฟ้าจากแรงดันภายนอกเช่นเดียวกับการไบอัสไปข้างหน้า แต่จะต่างตรงที่บริเวณ

ปลดพาหะกว้างขึ้น เป็นผลให้การแพร่ของอิเล็กตรอนอิสระและโฮลข้ามรอยต่อได้ลดลง เราเรียกการไบอัสแบบนี้ว่า “การไบอัสย้อนกลับ (reverse bias)” หรือบางทีอาจเรียกว่า “ไบอัสกลับ”

เราอาจสรุปได้ว่า ไดโอดรอยต่อเมื่อถูกไบอัสไปข้างหน้าจะยอมให้กระแสไหลผ่านรอยต่อมาก ในทางกลับกัน หากให้ไดโอดรอยต่อได้รับไบอัสย้อนกลับจะมีกระแสไหลผ่านไดโอดรอยต่อน้อยมากๆ

เรานำเอาไดโอดไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้ในวงจรเรียงกระแส (rectifier circuit) เพื่อทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟสลับให้เป็นแรงดันไฟตรง ใช้ในวงจรคงค่าแรงดัน (voltage regulator) และวงจรจำกัดแรงดัน (voltage limiting) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการนำเอาไดโอดไปใช้งานในวงจรทางแสงด้วย (optical circuit)

กระแสที่ไหลผ่านตัวไดโอดกับแรงดันที่ตกคร่อมไดโอด (ตามภาพที่ 1) มีความสัมพันธ์เป็นดังสมการ

$$i_D = I_S (e^{v_D/nV_T} - 1) \quad (1)$$

โดย I_S คือกระแสย้อนกลับอิ่มตัวของไดโอด (saturation current) สำหรับไดโอดรอยต่อซิลิกอนขนาดเล็กที่ใช้งานในวงจรกำลังต่ำจะมีค่าประมาณ 10^{-15} แอมแปร์ อีกทั้งมีค่าแปรตามอุณหภูมิ โดยทั่วไป I_S จะมีค่าเพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น 5 องศาเซลเซียส ส่วนแรงดัน V_T คือ แรงดันอุณหภูมิ (thermal voltage) มีค่าตามสมการ

$$V_T = \frac{kT}{q} \quad (2)$$

เมื่อ k เป็นค่าคงที่ของโบลต์ซมันน์ (Boltzmann's constant) มีค่าเท่ากับ 1.38×10^{-23} จูลต่อเคลวิน

T แทนอุณหภูมิสัมบูรณ์ในหน่วยเคลวินมีค่าเท่ากับ $273 +$ อุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส

q แทนค่าประจุไฟฟ้าของอิเล็กตรอนมีค่าเท่ากับ 1.60×10^{-19} คูลอมบ์

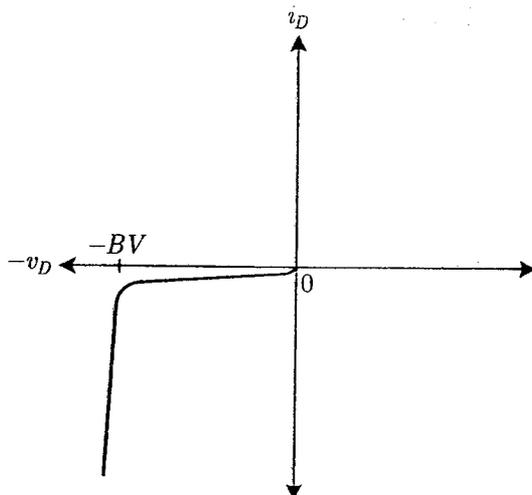
ณ อุณหภูมิห้องที่อยู่ในช่วงประมาณ 20 ถึง 30 องศาเซลเซียส แรงดันอุณหภูมิมียุ่ค่าประมาณ 25 ถึง 26 มิลลิโวลต์ เรามักเลือกใช้ 25 มิลลิโวลต์ แต่ก็มีหนังสือบางเล่มเลือกค่าเท่ากับ 26 มิลลิโวลต์ หมายเหตุ ไดโอดที่กล่าวถึงในที่นี้จะจำกัดเฉพาะไดโอดรอยต่อพี-เอ็น เท่านั้น

สมการที่ (1) นี้จะใช้อธิบายคุณสมบัติทางไฟตรงในอุดมคติของไดโอด เนื่องจากการพิสูจน์สมการนี้จะอาศัยการประมาณต่างๆ มากมาย อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นและในการใช้งานไดโอดพื้นฐานส่วนใหญ่ นั้น จะสามารถใช้สมการนี้อธิบายคุณสมบัติดังกล่าวได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดมากนัก ตัวแปรสำคัญที่แสดงคุณสมบัติในหัวข้อนี้ของไดโอดที่ปรากฏในสมการคือค่ากระแสย้อนกลับอิมิตัว I_S

ในการหาค่า I_S ของไดโอดจากการวัดนั้น เราจะไม่สามารถหาค่า I_S ได้จากการวัดกระแสในขณะที่ไดโอดได้รับการไบอัสย้อนกลับ (ที่มีค่าไม่มากกว่าหรือใกล้เคียงแรงดันเบรคดาวน์) เนื่องจากในความจริงแล้ว กระแสขณะที่ไดโอดได้รับการไบอัสดังกล่าวจะมีค่ามากกว่า I_S มาก เนื่องจากกระบวนการบางอย่าง ดังนั้นในทางปฏิบัติเราจะวัดค่า I_S นี้ได้ในขณะที่ไดโอดได้รับการไบอัสไปข้างหน้าเป็นหลัก

จุดสำคัญที่จะเน้นอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับค่ากระแสของไดโอด คือการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของกระแสดังกล่าว โดยเราจะสรุปได้ว่ากระแส I_S จะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิขณะที่ v_D มีค่าคงที่ (หรืออีกนัยหนึ่งก็คือไดโอดจะนำกระแสมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ขณะแรงดันไบอัสไดโอดคงที่) ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการแปรเปลี่ยนตามอุณหภูมิอย่างมากของ I_S เป็นหลัก ถึงแม้ว่าในสมการ (1) จะได้แสดงการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิในตัวแปร V_T ไว้แล้วก็ตาม

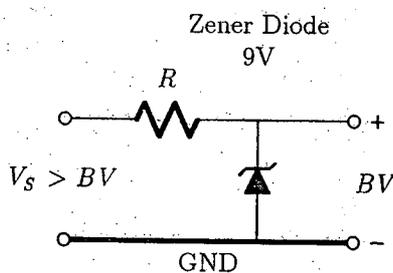
จากผลที่กล่าวข้างต้น เราสามารถสรุปคุณสมบัติสำคัญที่มีประโยชน์ของไดโอดได้ว่า “ไดโอดเป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำกระแสได้ทางเดียว (คือในขณะที่ไดโอดได้รับไบอัสไปข้างหน้า) และปริมาณกระแสที่ไดโอดนำ ที่ศักดาาคงที่ใดๆ จะขึ้นอยู่กับค่ากระแสย้อนกลับอิมิตัวของไดโอดนั้น” อย่างไรก็ตามยังมีคุณสมบัติทางไฟตรงของไดโอดที่มีความสำคัญและไม่สามารถใช้สมการที่ (1) มาอธิบายได้ ก็คือ คุณสมบัติที่เกิดจากปรากฏการณ์เบรคดาวน์ของไดโอดเมื่อได้รับการไบอัสย้อนกลับ โดยเราสามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ ด้วยกราฟความสัมพันธ์ของกระแสกับแรงดันของไดโอดดังแสดงไว้ในภาพที่ 2 ซึ่งจะเห็นว่าปรากฏการณ์นี้ทำให้แรงดันที่ตกคร่อมไดโอดมีค่าค่อนข้างคงที่ และไม่ขึ้นกับกระแสที่ไหลผ่านตัวไดโอดขณะได้รับไบอัสย้อนกลับ เราเรียกแรงดันที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เบรคดาวน์นี้ว่า “แรงดันเบรคดาวน์ของไดโอด (Break down Voltage: BV)” โดยค่าของแรงดันนี้จะขึ้นกับไดโอดแต่ละชนิดแต่ละเบอร์



ภาพที่ 2 ปรากฏการณ์เบรกดาวน์ของไดโอด

นอกจากคุณสมบัติที่สรุปข้างต้น เรายังนำไดโอดมาใช้เป็นแรงดันอ้างอิงสำหรับ วงจรอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย แต่ในความเป็นจริงแล้ว แรงดันเบรกดาวน์ของไดโอดแบบธรรมดาทั่วไป จะมีค่าสูง (อาจจะมากกว่า 50 โวลต์) ดังนั้น ในการที่จะใช้งานไดโอดสำหรับงานดังกล่าว ผู้ผลิตจึงได้ออกแบบและสร้างไดโอดที่มีค่าแรงดันเบรกดาวน์ต่ำ และสามารถควบคุมค่าแรงดันนี้ได้โดยผู้ผลิต เราเรียกไดโอดที่ใช้งานเฉพาะงานนี้ว่า “ซีเนอร์ไดโอด” เช่น ซีเนอร์ไดโอดขนาด 9 โวลต์จะหมายถึง ไดโอดที่ถูกออกแบบมาให้มีแรงดันเบรกดาวน์ประมาณ 9 โวลต์ หรือใช้งานเป็นแรงดันอ้างอิง 9 โวลต์ ดังแสดงในภาพที่ 3

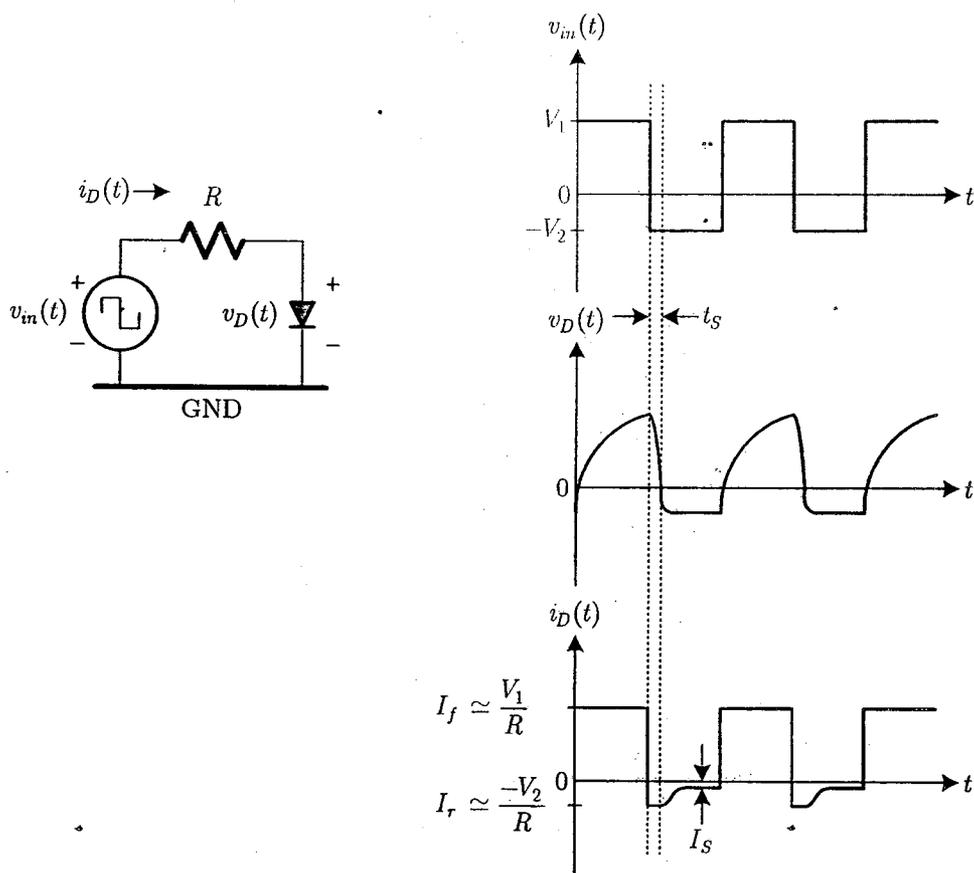
สรุปคือ ซีเนอร์ไดโอดจะถูกใช้งานในช่วงที่ได้รับการไบอัสย้อนกลับเป็นหลัก ดังนั้น คุณสมบัติในช่วงไบอัสไปข้างหน้าของซีเนอร์ไดโอดก็จะไม่มีความสำคัญ



ภาพที่ 3 สัญลักษณ์และตัวอย่างการใช้งานซีเนอร์ไดโอดเป็นแรงดันอ้างอิง 9 โวลต์

3.3 คุณสมบัติทางการสวิตช์ของไดโอด

คุณสมบัติทางการสวิตช์ของไดโอด (หรือคุณสมบัติที่สภาวะชั่วคราวของไดโอด) การใช้งานไดโอดในงานที่มีการเปลี่ยนแปลงของแรงดันและกระแสอย่างฉับพลัน เช่น งานด้านวงจรดิจิทัล เป็นต้น คุณสมบัติทางการสวิตช์ของไดโอดจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยปกติแล้ว เราคงจะต้องการให้การเปลี่ยนแปลงของช่วงการทำงานของไดโอด จากช่วงไบอัสไปข้างหน้าไปยังช่วงไบอัสย้อนกลับ หรือกลับกันเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสำหรับไดโอดสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 4



ภาพที่ 4 คุณสมบัติทางสวิตช์ของไดโอด

จากรูปจะเห็นได้ชัดเจนว่า ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เวลาค่าหนึ่ง ซึ่งก็คือเวลา t_s โดยเราจะแยกช่วงเวลานี้ว่า “เวลาหน่วงจากการสะสม (storage delay time)” ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดเวลาหน่วงดังกล่าวนี้ก็คือ ความเฉื่อยของประจุพาหะที่สะสมในตัวไดโอด ทั้งในบริเวณพลอตพาหะและบริเวณที่เป็นกลาง (คล้ายกับความเฉื่อยของประจุพาหะที่สะสมในตัวเก็บ

ประจุที่เราคุ้นเคย จึงทำให้เกิดแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันทีทันใด)

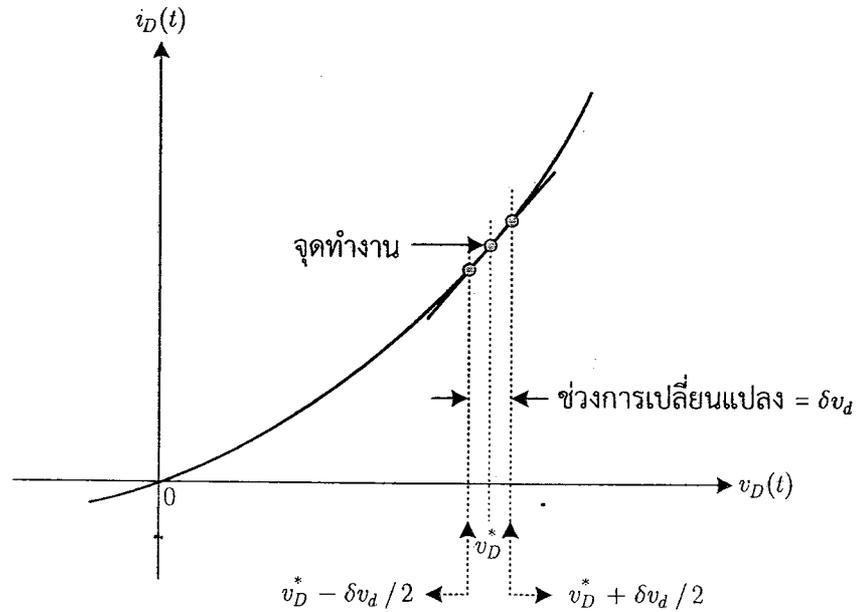
โดยปกติแล้ว เราสามารถลดเวลาหน่วงในการเปลี่ยนแปลงลงได้ โดยการควบคุมตัวแปรทางกายภาพของไดโอด เช่น การลดค่าเวลาชีวิต (life time) ของพาหะในสารกึ่งตัวนำ ที่ใช้ทำไดโอด โดยการโด๊ป (dope) ทอง ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ไดโอดบางชนิดไม่ได้ถูกออกแบบให้ใช้กับงานการสวิตช์ เช่น ไดโอดเรกติไฟร์ เป็นต้น จึงไม่จำเป็นต้องถูกออกแบบให้มีค่า t_s ต่ำ ดังนั้น ในการเลือกใช้งานไดโอดสำหรับวงจรที่เราออกแบบ จึงต้องคำนึงถึงลักษณะของงานเป็นสำคัญ จุดสำคัญที่จะเน้นในหัวข้อนี้ก็คือ การเปลี่ยนแปลงของค่าเวลา t_s ที่ขึ้นอยู่กับค่ากระแส I_f และ I_r (ดูภาพที่ 4 ประกอบ) โดยเวลา t_s จะมีค่ามากขึ้นถ้ากระแส I_f มีค่ามากขึ้น (ขณะ I_r คงที่) และจะมีค่าน้อยลงเมื่อ I_r มีค่าเพิ่มขึ้น (ขณะ I_f คงที่) ซึ่งทำให้เราสรุปได้ว่า การกล่าวถึงค่า t_s นี้ จะต้องกำหนดเงื่อนไขของกระแส I_f และ I_r ด้วย ซึ่งโดยปกติจะกำหนดเป็นอัตราส่วน I_r / I_f

3.4 คุณสมบัติทางสัญญาณระดับต่ำ

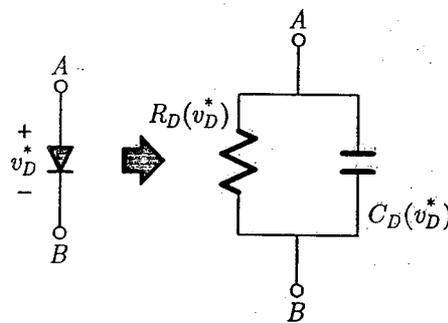
จากคุณสมบัติทั้งสองข้อที่กล่าวมาข้างต้นของไดโอด เราได้แสดงถึงคุณสมบัติความไม่เป็นเชิงเส้นของไดโอดเกี่ยวกับคุณสมบัติทางด้านสถิตย์ (กระแส, แรงดันไม่มีการเปลี่ยนแปลง) และคุณสมบัติทางด้านพลวัต (กระแส, แรงดันมีการเปลี่ยนแปลง) ซึ่งจะเห็นได้ว่าพอเพียงกับการอธิบายคุณสมบัติพื้นฐานที่ใช้งานทั้งหมดของไดโอดแล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะที่ไดโอดถูกใช้งานในลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงของแรงดันและกระแสจำกัดอยู่ในช่วงที่เล็กมากอยู่ช่วงหนึ่ง ดังเช่นที่แสดงในภาพที่ 5 นั้น เราจะสามารถแสดงคุณสมบัติทางพลวัตของไดโอด โดยการจำลองไดโอดด้วยอุปกรณ์เชิงเส้น ดังแสดงไว้ในภาพที่ 6 เพื่อประโยชน์ในการช่วยให้การคำนวณคุณสมบัติดังกล่าวทำได้ง่ายขึ้น เราเรียกแบบจำลองดังกล่าวนี้ว่า “แบบจำลองที่สัญญาณระดับต่ำ (small-signal model)” ของไดโอด แบบจำลองดังกล่าวประกอบด้วยการขนานกันของตัวต้านทานและตัวเก็บประจุโดยความต้านทาน R_D มีค่าเท่ากับ

$$R_D = \frac{V_T}{I_S e^{-v_D/v_T}} \quad (3)$$

หรืออีกนัยหนึ่งก็คือส่วนกลับของความชันของสมการที่ (3) ที่แรงดันเท่ากับ v_D^* ส่วนค่าความเก็บประจุ C_D จะขึ้นอยู่กับตัวแปรทางกายภาพของไดโอด โดยปกติค่า C_D จะเกิดจากผลของพาหะที่สะสมในบริเวณปลอดพาหะและบริเวณที่เป็นกลางในตัวไดโอดเป็นหลัก มีค่าอยู่ในระดับพิโคฟารัด (เราจึงจะไม่กล่าวถึงในรายละเอียด)

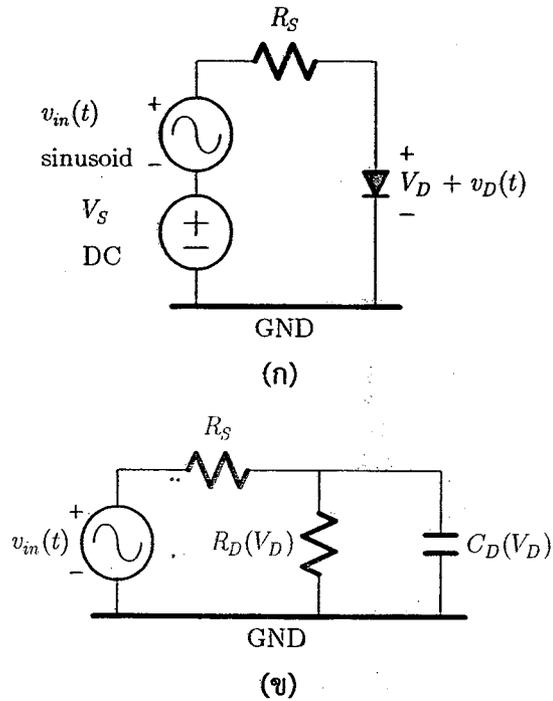


ภาพที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของแรงดันและกระแสของไดโอดที่จำกัดอยู่ในช่วงที่เล็กมากช่วงหนึ่ง



ภาพที่ 6 แบบจำลองที่สัญญาณระดับต่ำของไดโอด

จุดสำคัญที่จะเน้นให้นักศึกษาจดจำไว้เกี่ยวกับการใช้งานแบบจำลองดังกล่าวคือ แบบจำลองนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อการเปลี่ยนแปลงของแรงดันและกระแสของไดโอดมีค่าต่ำมากๆ และมีค่าขึ้นอยู่กับระดับแรงดันที่กำหนดจุดกลางของการเปลี่ยนแปลง (v_D^* และ v_D^* ในภาพที่ 5) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “จุดทำงานของไดโอด” อีกทั้งแบบจำลองดังกล่าวยังมีความสำคัญมากในการคำนวณคุณสมบัติทางไฟสลบที่สัญญาณระดับต่ำของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่นักศึกษาจะได้เรียนต่อไป ภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างการใช้งานแบบจำลองของไดโอด โดยเราจะหาผลตอบสนองทางความถี่ของค่าอัตราขยายแรงดัน (v_{out}/v_{in}) โดยไดโอดถูกไบอัสไว้ให้มีจุดทำงานที่ V_D ด้วยแหล่งจ่าย V_S และ v_{in} เป็นสัญญาณคลื่นรูปไซน์ (sinusoidal signal) มีค่าแรงดันแบบยอตประมาณ 5 มิลลิโวลต์



ภาพที่ 7 ตัวอย่างวงจรที่ใช้แบบจำลองที่สัญญาณระดับต่ำของไดโอดเพื่อหาผลตอบสนองทางความถี่
(ก) วงจรเริ่มต้น และ (ข) วงจรที่แสดงเฉพาะสัญญาณที่เปลี่ยนแปลง

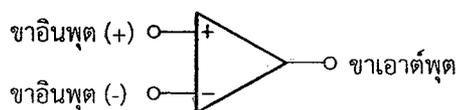
3.5 ออปแอมป์

วงจรรขยายเชิงเนื้องาน (Operational amplifier) หรือเรียกสั้นๆว่า ออปแอมป์ (Op-AMP) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีใช้งานกันอย่างแพร่หลายและได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะใช้งานง่าย มีเสถียรภาพทางวงจรสูง โดยในช่วงแรกๆ ออปแอมป์ถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้อุปกรณ์แบบดิสครีต (discrete component) เช่น หลอดสุญญากาศและทรานซิสเตอร์ เทคโนโลยีการผลิตสารกึ่งตัวนำได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ ออปแอมป์จึงถูกสร้างขึ้นในรูปวงจรรวม (Monolithic Op-AMP) นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จึงมีออปแอมป์ให้เลือกใช้งานมากมายอีกทั้งมีราคาค่อนข้างถูก หาซื้อง่ายในปัจจุบัน

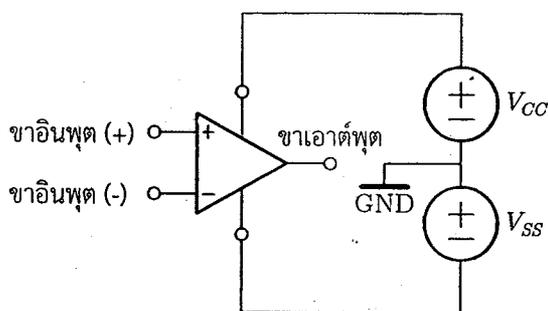
เราสามารถนำเอาออปแอมป์ไปใช้เป็นส่วนประกอบหลักในวงจรเชิงเส้น เช่น วงจรรขยายผลต่างของสัญญาณ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการนำเอาออปแอมป์ไปใช้ในวงจรไม่เชิงเส้น เช่น วงจรเรียงกระแส (rectifier circuit) วงจรกำเนิดสัญญาณ (signal oscillator) วงจรปรับค่าขยายอัตโนมัติ (automatic gain control: AGC) วงจรขมิตต์ทริกเกอร์ ในที่นี้จะขออธิบายเฉพาะการนำไปใช้ในวงจรที่เป็นเชิงเส้นเท่านั้น

ก) แบบจำลองของออปแอมป์

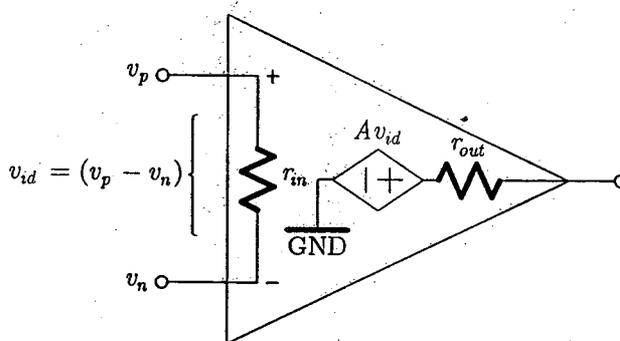
ออปแอมป์เป็นอุปกรณ์ที่มีสามขั้ว กล่าวคือมีขั้วอินพุตขาบวก (non-inverting input terminal) ขั้วอินพุตขาลบ (inverting input terminal) และขั้วเอาต์พุต (output terminal) โครงสร้างภายในออปแอมป์ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นอุปกรณ์แอกทีฟ ดังนั้นเราจึงต้องจ่ายแรงดันไฟตรงให้กับออปแอมป์เพื่อให้ออปแอมป์ทำงาน



(ก)



(ข)



(ค)

ภาพที่ 8 ออปแอมป์ (ก) สัญลักษณ์ทั่วไป (ข) การต่อแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า และ (ค) แบบจำลองอย่างง่าย

ออปแอมป์ที่ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นดังภาพที่ 8 โดยภาพที่ 8(ก) แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ในวงจร มีการต่อแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าเป็นดังภาพที่ 8(ข) ขณะภาพที่ 8(ค) แสดงแบบจำลองอย่างง่ายของออปแอมป์ จากแบบจำลองจะเห็นว่าออปแอมป์เป็นวงจรขยายแรงดันที่ทำหน้าที่ขยายผลต่างแรงดันของสัญญาณอินพุต ในทางอุดมคติออปแอมป์ (ideal op-amp) มีคุณสมบัติเป็นดังนี้

- อัตราขยายรูปเปิด (open-loop gain: A) มีค่าสูงมากเป็นอนันต์
- ความต้านทานขาเข้า r_{in} มีค่าสูงมากเป็นอนันต์
- ความต้านทานขาออก r_{out} มีค่าต่ำมากเป็นศูนย์
- ออปแอมป์จะขยายเฉพาะความต่างแรงดันที่ขาอินพุตบวกและลบเท่านั้น นั่นแสดงว่าถ้าขาอินพุตบวกและลบมีค่าเท่ากันจะไม่เกิดการขยายแรงดันขึ้นที่เอาต์พุต
- กระแสที่ไหลเข้าขาอินพุตบวกและลบมีค่าน้อยมากจนเป็นศูนย์ เนื่องจากความต้านทานขาเข้ามีค่าเป็นอนันต์
- ความต้านทานขาออกที่มีค่าต่ำมากเป็นศูนย์นั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อแรงดันเอาต์พุตแต่อย่างใด
- ออปแอมป์สามารถจ่ายและรับกระแส (source and sink) ได้ไม่จำกัด
- กระแสที่ไหลออกจากขาเอาต์พุตมีค่าน้อยมากจนเป็นศูนย์

ข) ความไม่เป็นอุดมคติของออปแอมป์

ในทางปฏิบัติ ออปแอมป์มีคุณสมบัติที่ต่างจากอุดมคติหลายประการเช่น อัตราขยาย ความต้านทานขาเข้าและความต้านทานขาออก ระดับแรงดันเอาต์พุต แรงดันออฟเซตทางอินพุต กระแสไบอัส แบนด์วิดท์ อัตราขยาย-แบนด์วิดท์ อัตราสลัวร์และแบนด์วิดท์เต็มกำลัง มีรายละเอียดโดยคร่าวเป็นดังนี้

อัตราขยาย ความต้านทานขาเข้าและขาออก ในทางปฏิบัติ ออปแอมป์จะมีอัตราขยายและความต้านทานขาเข้าที่สูงมากแต่ไม่ถึงค่าอนันต์ ขณะเดียวกัน แม้ว่าความต้านทานขาออกจะมีค่าต่ำมาก แต่ก็ไม่ถึงศูนย์โอห์ม

ระดับแรงดันเอาต์พุต ในทางปฏิบัติ แม้ว่าอัตราขยายของออปแอมป์จะมีค่าสูง แต่เมื่อพิจารณาถึงระดับแรงดันเอาต์พุตที่ได้กลับพบว่ามีความไม่เกินแหล่งจ่ายแรงดันไฟตรงที่จ่ายให้กับออปแอมป์ จึงทำให้กราฟถ่ายโอนแรงดันของออปแอมป์จะมีช่วงอิ่มตัว (saturation region) กล่าวคือ ในช่วงอิ่มตัวจะมีค่าอัตราขยายต่ำมา

แรงดันออฟเซตทางอินพุต แม้ว่าจะทำให้แรงดันอินพุตขาบวกและแรงดันอินพุตขาลบมีค่าเท่ากันได้โดยอาศัยการป้อนกลับแบบลบ (negative feedback) ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาแรงดันเอาต์พุตที่ได้กลับมีค่าไม่เท่ากับศูนย์ ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องปรับให้แรงดันอินพุตขาบวกและขาลบมีค่าต่างกันเล็กน้อยจนทำให้แรงดันที่เอาต์พุตมีค่าเป็นศูนย์ เราเรียกแรงดันอินพุตที่ขาออปแอมป์ซึ่งมีค่าต่างจากเดิมนี้อีกว่า “แรงดันออฟเซตทางอินพุต” อย่างไรก็ตาม ค่าแรงดันออฟเซตนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของออปแอมป์เบอร์นั้นๆ นอกจากนี้แล้ว ยังมีศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแรงดันออฟเซตทางเอาต์พุตอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการนิยามว่า เป็นแรงดันทางเอาต์พุตที่เกิดขึ้นจากการที่วงจรรขยายออปแอมป์อินพุตเป็นศูนย์

กระแสไบอัสอินพุตและกระแสออฟเซต เป็นกระแสอินพุตของออปแอมป์ที่เกิดจากการมีกระแสไหลเข้าหรือไหลออกจากขาอินพุตทั้งสองของออปแอมป์ เราเรียกค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกระแสอินพุตทั้งสองขานี้ว่า “กระแสไบอัสอินพุต” และเรียกค่าความแตกต่างของกระแสระหว่างขาอินพุตทั้งสองว่า “กระแสออฟเซต”

แบนด์วิดท์ โดยทั่วไป ออปแอมป์ในสภาวะปกติซึ่งไม่มีการป้อนกลับจะมีแบนด์วิดท์แคบมาก แต่หากมีการป้อนกลับแบบลบเกิดขึ้นแล้วจะมีแบนด์วิดท์กว้างขึ้นตามสมการความสัมพันธ์ต่อไปนี้

$$BW = BW_0 \left(\frac{A}{K} \right) \quad (4)$$

เมื่อ	BW	แทนแบนด์วิดท์ของออปแอมป์ที่มีการป้อนกลับ
	BW_0	แทนแบนด์วิดท์ของออปแอมป์ที่ไม่มีการป้อนกลับ
	A	แทนอัตราขยายของออปแอมป์ และ
	K	แทนอัตราขยายของวงจรรขยายสัญญาณ

อัตราขยาย-แบนด์วิดท์ คือ ผลคูณของอัตราขยายไฟตรงกับแบนด์วิดท์ขณะไม่มีการป้อนกลับของออปแอมป์

$$GBW = A \times BW_0 \quad (5)$$

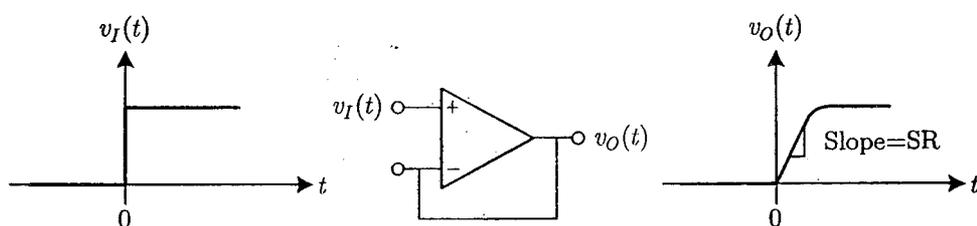
จากความสัมพันธ์ของสมการ อธิบายเพิ่มเติมได้ว่า หากต้องการอัตราขยายไฟตรงมีค่าสูงๆ แล้วผลที่ตามมาก็คือแบนด์วิดท์ของออปแอมป์จะลดลง นั่นเอง

อัตราสลับและแบนด์วิดท์เต็มกำลัง โดยอัตราสลับจะเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงแรงดันเอาต์พุตสูงสุดของออปแอมป์ มีค่าเป็นดังนี้

$$SR = \left. \frac{dv_{out}}{dt} \right|_{\max} \quad (6)$$

อัตราสลับสามารถวัดได้โดยการป้อนสัญญาณอินพุตแบบขั้นบันไดขนาดใหญ่ให้กับวงจรขยายสัญญาณแบบบัฟเฟอร์ (buffer amplifier) ส่วนแบนด์วิดท์เต็มกำลัง (full-power bandwidth: ω_m) เป็นแบนด์วิดท์ที่ทำให้เกิดแรงดันเอาต์พุตสวิงได้สูงสุดโดยไม่เกิดความผิดเพี้ยนขึ้นเลย ความถี่ของสัญญาณ ω จะต้องมีค่าเท่ากับ

$$\omega \leq \omega_m = \frac{SR}{|V_{out}|_{\max}} \quad (7)$$



ภาพที่ 9 การวัดอัตราสลับของออปแอมป์โดยอาศัยการป้อนสัญญาณแบบขั้นบันได

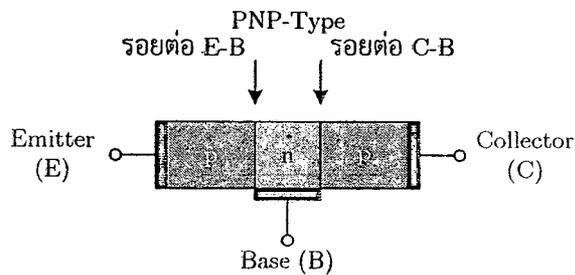
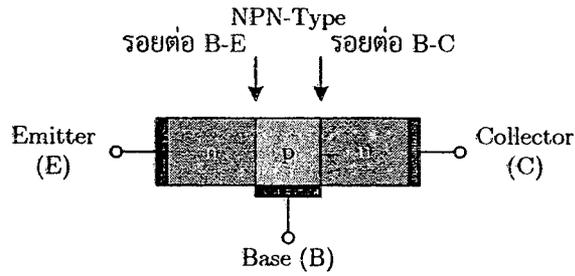
ค) การนำไปใช้งาน

การนำเอาออปแอมป์ไปใช้งานนั้น ส่วนใหญ่จะใช้เป็นวงจรประมวลผลสัญญาณเชิงเส้น เช่น วงจรขยายสัญญาณแบบกลับเฟส (inverting amplifier) วงจรขยายแบบไม่กลับเฟส (non-inverting amplifier) วงจรรวมแรงดันสัญญาณ (summing amplifier) วงจรขยายแรงดันผลต่าง (difference amplifier) และวงจรขยายเครื่องมือวัด (instrumentation amplifier) เป็นต้น

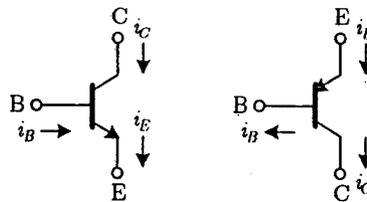
นอกจากนี้แล้ว เรายังใช้ออปแอมป์ในวงจรแบบไม่เป็นเชิงเส้นด้วย เช่น วงจรเรกติไฟเออร์ (rectifier circuit) วงจรปรับอัตราขยายสัญญาณอัตโนมัติ (automatic gain control: AGC) วงจรขมิตต์ทริกเกอร์ (schmit-trigger circuit) วงจรกำเนิดสัญญาณรูปเหลี่ยม (oscillator circuit) เป็นต้น

พื้นที่สารกึ่งตัวนำสามส่วนคือ อิมิตเตอร์ (emitter: E) เบส (base: B) และคอลเลกเตอร์ (collector:

C)



(ก)



NPN-Type

PNP-Type

(ข)

ภาพที่ 10 ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ชนิด NPN และ PNP (ก) โครงสร้างทางกายภาพ

และ (ข) สัญลักษณ์เชิงวงจร

กรณีทรานซิสเตอร์ชนิด NPN มีขาอิมิตเตอร์และขาคอลเลกเตอร์ ซึ่งเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น ประกอบเข้าด้านซ้ายและขวามือโดยมีขาเบสซึ่งเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดพีอยู่ตรงกลาง

กรณีทรานซิสเตอร์ชนิด PNP มีขาอิมิตเตอร์และขาคอลเลกเตอร์ ซึ่งเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดพี ประกอบเข้าด้านซ้ายและขวามือโดยมีขาเบสซึ่งเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็นอยู่ตรงกลาง

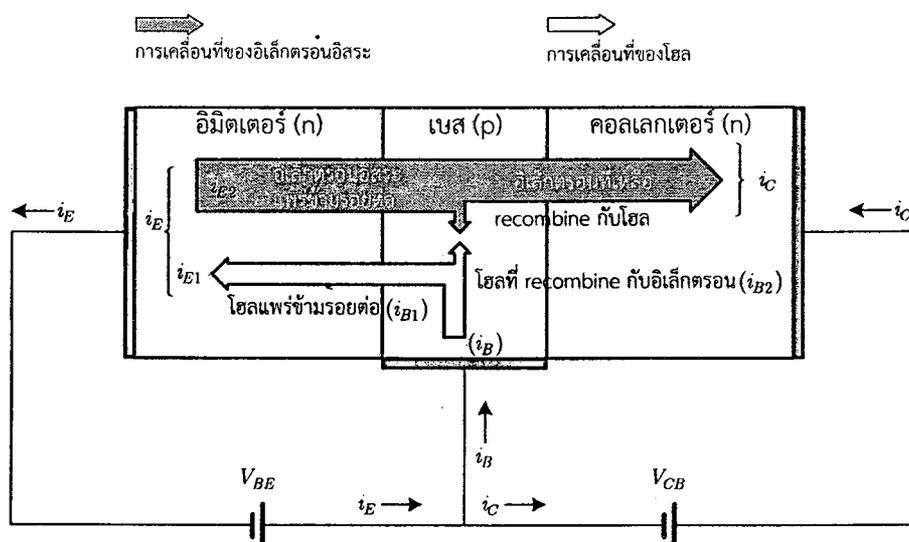
ทั้งทรานซิสเตอร์ชนิด NPN และ PNP นั้นมีการทำงานแบ่งออกเป็น 3 สถานะ กล่าวคือ สถานะคัตออฟ (cut-off) สถานะแอกทีฟ (active) และสถานะอิ่มตัว (saturation) แต่ละสถานะใช้การพิจารณาจากลักษณะการไบอัสแบบไปข้างหน้า (forward bias) และย้อนกลับ (reverse bias) ดังนี้

สถานะ	BEJ	BCJ
สถานะคัตออฟ	ย้อนกลับ	ย้อนกลับ
สถานะแอกทีฟ	ไปข้างหน้า	ย้อนกลับ
สถานะอิ่มตัว	ไปข้างหน้า	ไปข้างหน้า

ก) การทำงานทางกายภาพ

กรณีทรานซิสเตอร์ชนิด NPN

สถานะคัตออฟ (cut-off) ถ้ารอยต่อเบส-อิมิตเตอร์ และเบส-คอลเลกเตอร์ได้รับไบอัสย้อนกลับ (reverse bias) จะไม่มีกระแสไหลผ่านรอยต่อทั้งสองเลย (ไหลน้อยมาก) นั่นคือ $i_B = i_C = i_E = 0$ จะเห็นได้ว่าในสถานะเช่นนี้ขาคอลเลกเตอร์จะถูกตัดขาดออกจากขาอิมิตเตอร์โดยสิ้นเชิง



ภาพที่ 11 การไบอัสในสถานะแอกทีฟไปข้างหน้าสำหรับทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ชนิด NPN

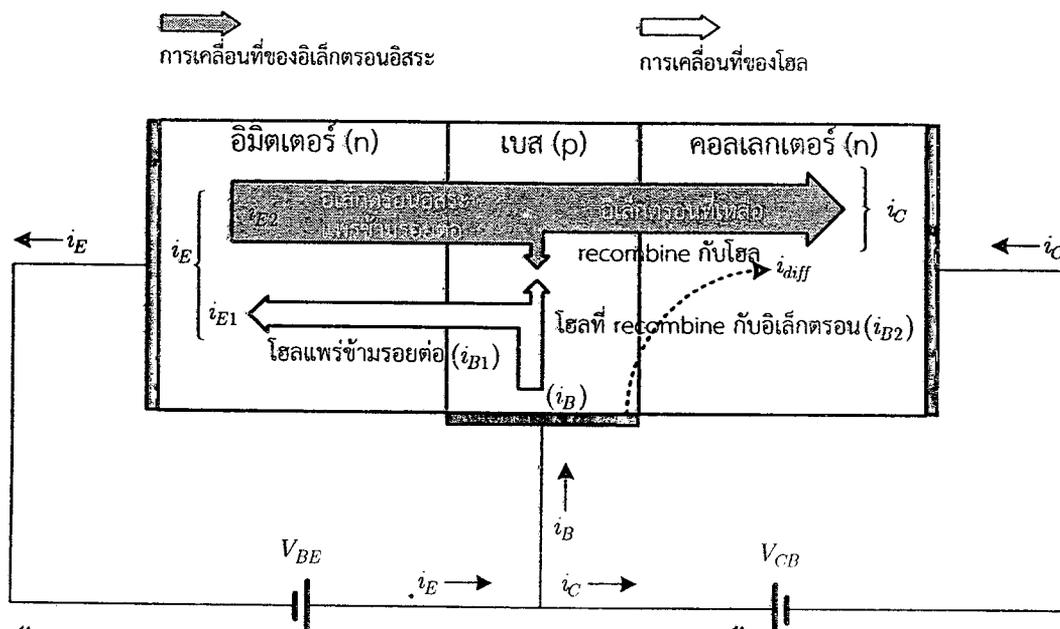
สถานะแอกทีฟ (active) กรณีของทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์จะทำงานได้ถ้าให้รอยต่อเบส-อิมิตเตอร์ ได้รับไบอัสไปข้างหน้า ส่วนรอยต่อเบส-คอลเลกเตอร์จะต้องได้รับไบอัสย้อนกลับ

จากภาพที่ 11 จะเห็นได้ว่า กระแส i_E ประกอบด้วยกระแสอิเล็กตรอนที่เกิดจากการแพร่ของอิเล็กตรอนจากอิมิตเตอร์ไปยังเบส และกระแสโฮลที่เกิดจากการแพร่ของโฮลจากเบสไปยังอิมิตเตอร์ โดยทั่วไป ทรานซิสเตอร์ได้ถูกออกแบบให้กระแสอิเล็กตรอนมีขนาดใหญ่กว่ากระแสโฮลมาก ซึ่งสามารถทำได้โดยการแพร่ให้สารเจือในอิมิตเตอร์มีความหนาแน่นสูงกว่าสารเจือในเบสมาก ส่งผลให้ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนอิสระในอิมิตเตอร์มีค่าสูงกว่าความหนาแน่นของโฮลในเบสมากเช่นกัน

อิเล็กตรอนที่เกิดการแพร่จากอิมิตเตอร์เข้าสู่เบสนี้จะกลายเป็นพาหะส่วนน้อย (minority carriers) ในเบส [ขณะที่พาหะส่วนใหญ่ (majority carriers) เป็นโฮล] อิเล็กตรอนเหล่านี้บางส่วนจะรวมตัว (recombination) กับโฮลในเบส แต่เนื่องจากรอยต่อที่เบส-คอลเลกเตอร์ได้รับไบอัสย้อนกลับ ทำให้สนามไฟฟ้าที่บริเวณรอยต่อจะดึงอิเล็กตรอนที่ถูกฉีดเข้ามาให้เลื่อนไปยังบริเวณคอลเลกเตอร์ และเคลื่อนที่ออกจากทรานซิสเตอร์ไปสู่วงจรมานอก การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนดังกล่าวจะทำให้เกิดกระแสอิเล็กตรอนวิ่งเข้าสู่ขาคอลเลกเตอร์ โดยเราจะเรียกกระแสดังกล่าวว่า กระแสคอลเลกเตอร์ (collector current: i_c) ทั้งนี้ เนื่องจากทรานซิสเตอร์โดยทั่วไปจะมีบริเวณที่เบสแคบ อิเล็กตรอนส่วนใหญ่จึงสามารถเคลื่อนที่ข้ามเบสเข้าไปสู่คอลเลกเตอร์ได้

พิจารณาภาพที่ 11 อีกครั้ง จะเห็นได้ว่า กระแสที่ไหลเข้าสู่เบส ซึ่งเราเรียกว่า กระแสเบส (base current: i_b) จะประกอบด้วยกระแสสองส่วน กล่าวคือ กระแสเบสส่วนแรก (i_{B1}) เกิดจากกระแสโฮลที่แพร่ผ่านรอยต่อเบส-อิมิตเตอร์ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ($i_{B1} = i_{E1}$) และกระแสเบสส่วนที่สอง (i_{B2}) นั้นเกิดจากการรวมตัวของโฮลและอิเล็กตรอนในบริเวณเบส ทั้งนี้ เนื่องจากในสถานะสมดุลจะมีอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่เข้ามาสู่บริเวณเบสในอัตราคงที่และอิเล็กตรอนเหล่านี้จะเกิดการรวมตัวกับโฮลที่เบส ดังนั้น เพื่อให้จำนวนโฮลในบริเวณเบสมีค่าคงที่ในสถานะสมดุล จึงต้องมีโฮลเคลื่อนที่เข้ามาที่บริเวณเบสด้วยอัตราคงที่ การเคลื่อนที่ของโฮลดังกล่าวจะทำให้เกิดการกระแส i_{B2} ไหลขึ้น โดยทั่วไปแล้ว เราต้องการให้กระแส i_b มีค่าน้อยๆ ซึ่งสามารถทำได้โดยแบ่งออกเป็นสองกรณี กล่าวคือ ทำให้เกิดการแพร่สารเจือบริเวณเบสอย่างเบาบางจะทำให้ i_{B1} มีค่าน้อยๆ ได้ หรือการสร้างทรานซิสเตอร์ที่มีบริเวณเบสแคบๆ จะทำให้เกิดการรวมตัวของกระแสที่เบสน้อยลง นั่นคือจะได้ i_{B2} มีค่าน้อยๆ ด้วย

สถานะอิ่มตัว (saturation) ถ้ารอยต่ออิมิตเตอร์-เบส และคอลเลกเตอร์-เบสได้รับไบอัสตรง (forward bias) ดังภาพที่ 12 จะเกิดการแพร่ของพาหะส่วนใหญ่ข้ามรอยต่อคอลเลกเตอร์-เบส จะทำให้มีกระแสไหลจากเบสไปยังคอลเลกเตอร์ได้ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า กระแสดังกล่าวจะไหลไปในทางเดียวกับกระแสเบส i_b แต่จะมีทิศสวนทางกับกระแส i_c หากเทียบกับในสถานะแอกทีฟจะพบว่า กระแสเบส i_b ในสถานะอิ่มตัวนี้มีค่าสูงชันกว่าในสถานะแอกทีฟ ขณะที่กระแสคอลเลกเตอร์ i_c จะลดลง ในที่สุดสถานะอิ่มตัวนี้มีอัตราขยายกระแส β ลดลง



ภาพที่ 12 การไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ชนิด NPN ในสถานะอิมิตัวอย่างอ่อน

นอกจากนี้ ถ้าเราให้แรงดันที่เบส-คอลเลกเตอร์ V_{BC} มีค่าสูงมากพอ จะทำให้กระแสคอลเลกเตอร์ i_C มีค่าตกลงจนเป็นศูนย์ เนื่องจากกระแสที่เกิดจากการเลื่อนของอิเล็กตรอนจากเบสไปสู่คอลเลกเตอร์นั้นจะถูกหักล้างด้วยกระแสที่เกิดจากการแพร่ของอิเล็กตรอนจากคอลเลกเตอร์สู่เบส และเมื่อแรงดันที่เบส-คอลเลกเตอร์ V_{BC} มีค่าสูงขึ้นไปอีก กระแสคอลเลกเตอร์ i_C จะเริ่มไหลย้อนกลับ

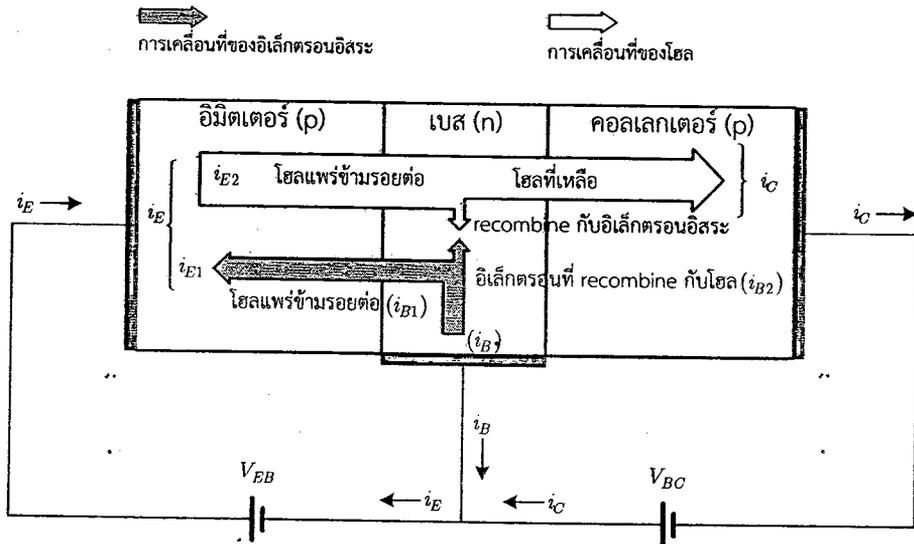
กรณีทรานซิสเตอร์ชนิด PNP

สถานะ	EBJ	CBJ
สถานะคัตออฟ	ย้อนกลับ	ย้อนกลับ
สถานะแอกทีฟ	ไปข้างหน้า	ย้อนกลับ
สถานะอิมิตัว	ไปข้างหน้า	ไปข้างหน้า

สถานะคัตออฟ (cut-off) ถ้ารอยต่ออิมิตเตอร์-เบส และคอลเลกเตอร์-เบสได้รับไบอัสย้อนกลับ (reverse bias) จะไม่มีกระแสไหลผ่านรอยต่อทั้งสองเลย (ไหลน้อยมาก) นั่นคือ $i_B = i_C = i_E = 0$ จะเห็นได้ว่าในสถานะเช่นนี้ขาคอลเลกเตอร์จะถูกตัดขาดออกจากขาอิมิตเตอร์โดยสิ้นเชิง

สถานะแอกทีฟ (active) กรณีของทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์จะทำงานได้ถ้าให้รอยต่ออิมิตเตอร์-เบส ได้รับไบอัสไปข้างหน้า (มีกระแสไหลจากอิมิตเตอร์ไปยังเบส) ส่วนรอยต่อคอลเลกเตอร์-เบส จะต้องได้รับไบอัสย้อนกลับ

สถานะแอกทีฟ (active) กรณีของทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์จะทำงานได้ถ้าให้รอยต่ออิมิตเตอร์-เบส ได้รับไบอัสไปข้างหน้า (มีกระแสไหลจากอิมิตเตอร์ไปยังเบส) ส่วนรอยต่อคอลเลกเตอร์-เบส จะต้องได้รับไบอัสย้อนกลับ



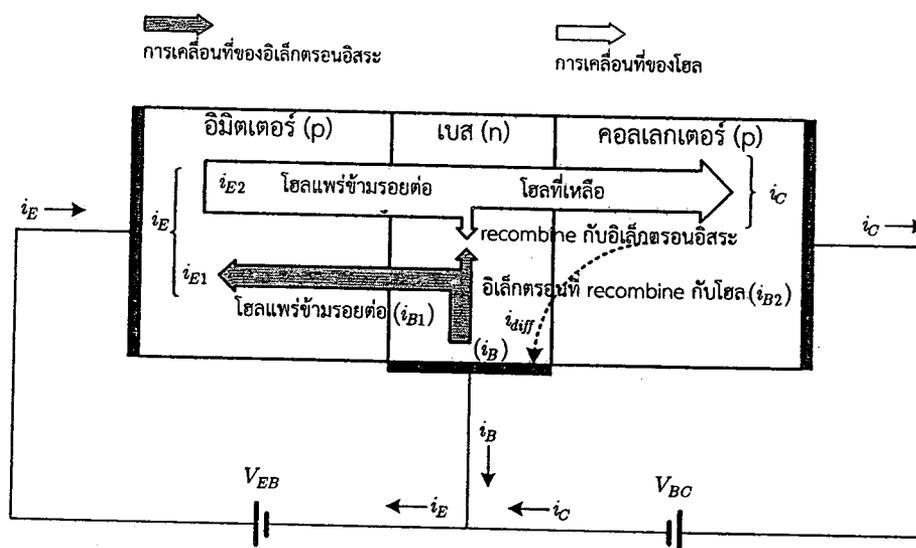
ภาพที่ 13 การไบอัสในสถานะแอกทีฟไปข้างหน้าสำหรับทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ชนิด PNP

จากภาพที่ 13 จะเห็นได้ว่า กระแส i_E ประกอบด้วยกระแสอิเล็กตรอนที่เกิดจากการแพร่ของอิเล็กตรอนจากเบสไปยังอิมิตเตอร์ (i_{E1}) และกระแสโฮลที่เกิดจากการแพร่ของโฮลจากอิมิตเตอร์ไปยังเบส (i_{E2}) โดยทั่วไป ทรานซิสเตอร์ชนิด PNP ได้ถูกออกแบบให้กระแสโฮลมีขนาดใหญ่มากกว่ากระแสอิเล็กตรอนมาก ($i_{E2} \gg i_{E1}$) ซึ่งสามารถทำได้โดยการแพร่ให้สารเจือในอิมิตเตอร์มีความหนาแน่นสูงกว่าสารเจือในเบสมาก ส่งผลให้ความหนาแน่นของโฮลในอิมิตเตอร์มีค่าสูงกว่าความหนาแน่นของอิเล็กตรอนอิสระในเบสมาก เช่นกัน

โฮลที่เกิดการแพร่จากอิมิตเตอร์เข้าสู่เบสนี้จะกลายเป็นพาหะส่วนน้อย (minority carriers) ในเบส [ขณะที่พาหะส่วนใหญ่ (majority carriers) เป็นอิเล็กตรอน] โฮลเหล่านี้บางส่วนจะรวมตัว (recombination) กับอิเล็กตรอนอิสระในเบส แต่เนื่องจากรอยต่อที่คอลเลกเตอร์-เบส ได้รับไบอัสย้อนกลับ ทำให้สนามไฟฟ้าที่บริเวณรอยต่อจะดึงโฮลที่ถูกฉีดเข้ามาให้เลื่อนไปยังบริเวณคอลเลกเตอร์และเคลื่อนที่ออกจากทรานซิสเตอร์ไปสู่วงจรภายนอก การเคลื่อนที่ของโฮลดังกล่าวจะทำให้เกิดกระแสโฮลวิ่งเข้าสู่ขาคอลเลกเตอร์ โดยเราจะเรียกกระแสดังกล่าวว่า กระแสคอลเลกเตอร์ (collector current: i_C) ทั้งนี้ เนื่องจากทรานซิสเตอร์โดยทั่วไปจะมีบริเวณที่เบสแคบ โฮลส่วนใหญ่จึงสามารถเคลื่อนที่ข้ามเบสเข้าไปสู่คอลเลกเตอร์ได้

พิจารณาภาพที่ 13 อีกครั้ง จะเห็นได้ว่า กระแสที่ไหลออกจากขาเบส ซึ่งเราเรียกว่า กระแสเบส (base current: i_B) จะประกอบด้วยกระแสสองส่วน กล่าวคือ กระแสเบสส่วนแรก (i_{B1}) เกิดจากกระแสโฮลที่แพร่ผ่านรอยต่ออิมิตเตอร์-เบส ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ($i_{B1} = i_{E1}$) และกระแสเบสส่วนที่สอง (i_{B2}) นั้นเกิดจากการรวมตัวของโฮลและอิเล็กตรอนในบริเวณเบส ทั้งนี้เนื่องจากในสถานะสมดุลจะมีโฮลแพร่เข้ามาสู่บริเวณเบสในอัตราคงที่และโฮลเหล่านี้จะเกิดการรวมตัวกับอิเล็กตรอนอิสระที่เบส ดังนั้น เพื่อให้จำนวนอิเล็กตรอนอิสระในบริเวณเบสมีค่าคงที่ในสถานะสมดุล จึงต้องมีอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่เข้ามาที่บริเวณเบสด้วยอัตราคงที่ การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระดังกล่าวจะทำให้เกิดการกระแส i_{B2} ไหลขึ้น โดยทั่วไปแล้ว เราต้องการให้กระแส i_B มีค่าน้อยๆ ซึ่งสามารถทำได้โดยแบ่งออกเป็นสองกรณี กล่าวคือ ทำให้เกิดการแพร่สารเจือบริเวณเบสอย่างเบาบางจะทำให้ i_{B1} มีค่าน้อยๆ ได้ หรือการสร้างทรานซิสเตอร์ที่มีบริเวณเบสแคบๆ จะทำให้เกิดการรวมตัวของกระแสที่เบสน้อยลง นั่นคือจะได้ i_{B2} มีค่าน้อยๆ ด้วย

สถานะอิ่มตัว (saturation) ถ้ารอยต่ออิมิตเตอร์-เบส และคอลเล็กเตอร์-เบสได้รับไบอัสตรง (forward bias) ดังภาพที่ 13 จะเกิดการแพร่ของพาหะส่วนใหญ่ข้ามรอยต่อคอลเล็กเตอร์-เบส จะทำให้มีกระแสไหลจากคอลเล็กเตอร์ไปยังเบสได้ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า กระแสดังกล่าวจะไหลไปในทางเดียวกับกระแสเบส i_B แต่จะมีทิศสวนทางกับกระแส i_C (ดังภาพที่ 14) หากเทียบกับในสถานะแอกทีฟจะพบว่า กระแสเบส i_B ในสภาวะอิ่มตัวนี้มีค่าสูงชันกว่าในสถานะแอกทีฟ ขณะที่กระแสคอลเล็กเตอร์ i_C จะลดลง ในที่สุดสภาวะอิ่มตัวนี้จะมีอัตราขยายกระแส β ลดลง

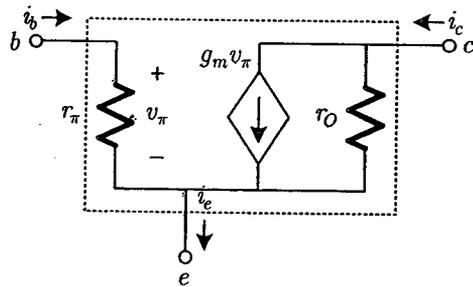


ภาพที่ 14 การไบอัสให้กับทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ชนิด PNP ในสถานะอิ่มตัวอย่างอ่อน

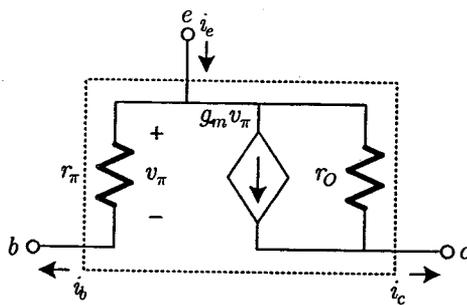
ข) แบบจำลองสัญญาณขนาดเล็ก

ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ชนิด NPN และ PNP มีแบบจำลองสัญญาณขนาดเล็ก (small-signal model) เป็นดังภาพที่ 15 โดยภาพที่ 15(ก) และ (ข) เป็นแบบจำลองสัญญาณขนาดเล็กของทรานซิสเตอร์ชนิด NPN และ PNP ตามลำดับโดยมีความต้านทานที่เชื่อมต่อระหว่างขาเบสและคอลเล็กเตอร์แทนค่าด้วย $r_\pi = V_T / I_B = \beta V_T / I_C$ มีแรงดันตกคร่อมค่าเท่ากับ v_π ส่วนระหว่างขาคอลเล็กเตอร์และเบสนั้นมีค่าทรานส์คอนดักแตนซ์สำหรับสัญญาณขนาดเล็ก (small-signal transconductance: g_m) เท่ากับ I_C / V_T (หรือบางครั้งอาจจะแทนด้วยอัตราขยายกระแส $\beta = I_C / I_B$) อย่างไรก็ตาม กระแส i_c นอกจากจะขึ้นกับแรงดันที่เบส-อิมิตเตอร์แล้ว ยังมีค่าขึ้นกับแรงดันที่เบส-คอลเล็กเตอร์อีกด้วย

เนื่องจากเมื่อแรงดันย้อนกลับที่ตกคร่อมรอยต่อเบส-คอลเล็กเตอร์มีค่าเพิ่มขึ้น บริเวณปอดพาหะรอบๆ รอยต่อดังกล่าวจะมีขนาดกว้างขึ้น ส่งผลให้ความกว้างที่เบสมีค่าแคบลง และกระแส i_c มีค่าสูงขึ้น เราเรียกว่า “ปรากฏการณ์เออร์ลีย์ (Early effect)” ทำให้เกิดความต้านทานระหว่างขาคอลเล็กเตอร์และเบส (r_o) ด้วย



(ก)



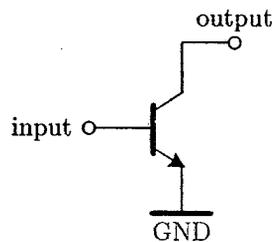
(ข)

ภาพที่ 15 แบบจำลองสัญญาณขนาดเล็กแบบไฮบริดพายของทรานซิสเตอร์ชนิด

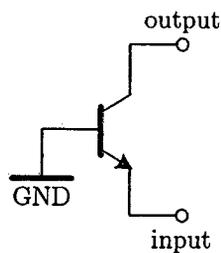
(ก) NPN และ (ข) PNP

ค) การนำทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ไปใช้งานเป็นวงจรขยายสัญญาณ

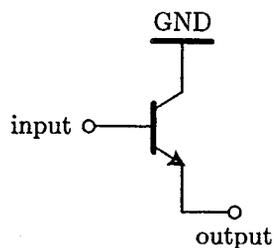
การใช้ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ไปใช้ในการขยายสัญญาณ เราสามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะคือ วงจรขยายแบบอิมิตเตอร์ร่วม (common emitter) วงจรขยายแบบเบสร่วม (common base) และวงจรขยายแบบคอลเลกเตอร์ร่วม (common collector) ซึ่งวงจรขยายแต่ละแบบแสดงได้ดังภาพที่ 16 (แสดงเฉพาะโครงสร้าง)



(ก)



(ข)



(ค)

ภาพที่ 16 ลักษณะของวงจรขยายสัญญาณแบบพื้นฐานที่ใช้ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์

(ก) วงจรขยายแบบอิมิตเตอร์ร่วม (ข) วงจรขยายแบบเบสร่วม

และ (ค) วงจรขยายแบบคอลเลกเตอร์ร่วม

โดยภาพที่ 16(ก) เป็นวงจรรขยายสัญญาณที่มีลักษณะเด่นคือ มีค่าอัตราขยายสูง เกิดการกลับเฟสของสัญญาณทางเอาต์พุตเมื่อเทียบกับสัญญาณอินพุต มีความต้านทานขาเข้าสูงปานกลาง และมีความต้านทานขาออกสูง

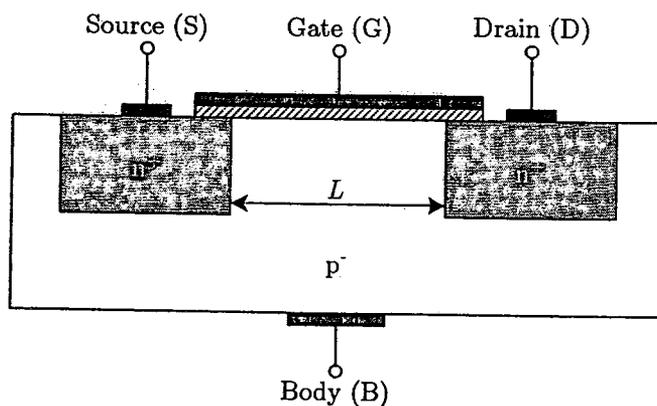
ภาพที่ 16(ข) เป็นวงจรรขยายสัญญาณที่มีลักษณะเด่นคือ มีค่าอัตราขยายสูง เกิดการกลับเฟสของสัญญาณทางเอาต์พุตเมื่อเทียบกับสัญญาณอินพุต มีความต้านทานขาเข้ามีค่าต่ำกว่าภาพที่ 16(ก) มาก และอัตราขยายโดยรวมของวงจรมีค่าต่ำมากเช่นกัน ส่วนความต้านทานขาออกมีค่าเท่ากับ ความต้านทานภายนอกที่ต่อเข้าที่ขาคอลเลกเตอร์ของทรานซิสเตอร์ ดังนั้น เราจะใช้วงจรรขยายนี้ใน โหมดกระแสทางกว่าโหมดแรงดัน (สัญญาณทางอินพุตจะอยู่ในรูปกระแสเสียเป็นส่วนใหญ่)

ส่วนภาพที่ 16(ค) เป็นวงจรรขยายสัญญาณที่มีลักษณะเด่นคือ อัตราขยายมีค่าประมาณ 1 มีความต้านทานขาเข้าสูง ส่วนความต้านทานขาออกมีค่าต่ำ เราจะใช้เป็นวงจรรบัปเฟอร์

3.7 ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า

ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่า “มอสเฟต” ย่อมาจากคำว่า Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor (MOSFET) ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะในกระบวนการผลิตสมัยใหม่สามารถบรรจุวงจรรวมทางด้านดิจิทัลที่มีความซับซ้อนให้อยู่บนฐานรองเดียวกันได้ จึงทำให้ได้วงจรรวมขนาดเล็ก โดยทั่วไปแล้ว มอสเฟต แบ่งได้สองประเภทคือ NMOS (N-channel MOSFET) และ PMOS (P-channel MOSFET) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มี 4 ขา

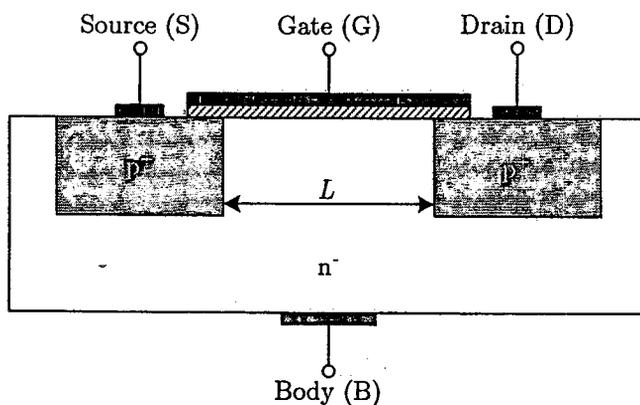
กรณีทรานซิสเตอร์ประเภท NMOS ประกอบด้วย ขาเกต (gate: G) เป็นขั้วที่ทำหน้าที่ต่อกับชั้นตัวนำ ส่วนขาเดรน (drain: D) และ ขาซอร์ส (source: S) เป็นขั้วที่ต่อกับสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น (n^+) ส่วนขาบอดี้ (body: B) เป็นขาที่ต่อกับโครงสร้างของอุปกรณ์ซึ่งเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดพี (p^-) ดังภาพที่ 17



ภาพที่ 17 ภาคตัดขวางของทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าประเภท NMOS

จากภาพที่ 17 จะเห็นว่า ระหว่างขาเกตและขาบอดี้ ประกอบด้วยชั้นตัวนำ [สมัยก่อนทำจากโลหะอลูมิเนียม แต่ปัจจุบันจะใช้โพลีซิลิกอน (poly-silicon)] ถัดลงมาเป็นชั้นซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO_2) หรือเรียกสั้นๆ ว่าชั้นออกไซด์ (Oxide) และชั้นถัดมาเรียกว่าชั้นสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) เมื่อพิจารณาภาพที่ 17 อีกครั้ง จะเห็นได้ว่า NMOS มีโครงสร้างที่สมมาตร เราสามารถสลับกันระหว่างขาเดรนกับขาซอร์สได้ แต่ในทางปฏิบัติ เราจะให้แรงดันที่ขาเดรนมีค่าสูงกว่าขาซอร์ส ($V_D > V_S$) เสมอ ส่วนแรงดันที่ป้อนให้ที่ขาเกตนั้น ถ้ามีค่าน้อยกว่าแรงดันที่ขาเดรนและขาซอร์สแล้ว ($V_G < V_D, V_S$) จะทำให้ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้านี้ไม่ทำงาน จึงไม่มีกระแสไหลจากขาเดรนไปยังขาซอร์สได้ (เสมือนเปิดวงจรระหว่างขาเดรนและขาซอร์ส: $I_{DS} = 0$) ในทางตรงข้าม หากเราให้แรงดันที่ขาเกตสูงจะเกิดช่องนำกระแสระหว่างขาเดรนกับขาซอร์สได้ ยังผลให้เกิดกระแสไหลจากขาเดรนไปหาขาซอร์ส ($I_{DS} > 0$) การต่อใช้งานในวงจร ขาบอดี้นิยมต่อเข้ากับแรงดันต่ำสุดของวงจร

กรณีทรานซิสเตอร์ประเภท PMOS ประกอบด้วย ขาเกต (gate: G) เป็นขั้วที่ทำหน้าที่ต่อกับชั้นตัวนำ ส่วนขาเดรน (drain: D) และ ขาซอร์ส (source: S) เป็นขั้วที่ต่ออยู่กับสารกึ่งตัวนำชนิดพี (p^+) ส่วนขาบอดี้ (body: B) เป็นขาที่ต่ออยู่กับโครงสร้างของอุปกรณ์ซึ่งเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น (n^-) ดังภาพที่ 18



ภาพที่ 18 ภาคตัดขวางของทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าประเภท PMOS

พิจารณาภาพที่ 18 จะเห็นได้ว่า PMOS มีโครงสร้างที่สมมาตร สามารถสลับขาเดรนกับขาซอร์สได้ ในทางปฏิบัติ เราจะให้แรงดันที่ขาซอร์สมีค่าสูงกว่าขาเดรน ($V_S > V_D$) เสมอ ส่วนแรงดันที่ป้อนให้ที่ขาเกตนั้น ถ้ามีค่ามากกว่าแรงดันที่ขาเดรนและขาซอร์สแล้ว ($V_G > V_D, V_S$) จะทำให้ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้านี้ไม่ทำงาน จึงไม่มีกระแสไหลจากขาซอร์สไปยังขาเดรนได้ (เสมือนเปิด

วงจรระหว่างชาซอร์สและชาเดรน: $I_{SD} = 0$) ในทางตรงข้าม หากเราให้แรงดันที่ชาเกตสูงจะเกิดช่องนำกระแสระหว่างชาซอร์สกับชาเดรนได้ ยังผลให้เกิดกระแสไหลจากชาซอร์สไปหาชาเดรน ($I_{SD} > 0$) การต่อใช้งานในวงจร ขาขอดีนิยมต่อเข้ากับแรงดันสูงสุดของวงจร

ก) การทำงานทางกายภาพ

กรณีทรานซิสเตอร์ชนิด NMOS

เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ สมมติให้ ทุกขาของทรานซิสเตอร์ประเภท NMOS ถูกต่อเข้ากับกราวด์ กรณีเช่นนี้จะทำให้เกิดบริเวณปลอดพาหะขึ้นที่บริเวณรอยต่อ ($p^- - n^+$) นั่นคือรอยต่อ B-S และรอยต่อ B-D

เมื่อเริ่มทำให้แรงดันที่เกตมีค่าเป็นลบ ($V_G < 0$) โอลในบริเวณขาขอดีจะถูกดึงดูดขึ้นมาบริเวณข้างบน ทำให้เกิดบริเวณ p^+ ขึ้นเรียกว่า “บริเวณรวมตัว (accumulation region)” ขึ้นได้ชั้นออกไซด์

ในทางตรงข้าม ถ้าทำให้แรงดันที่เกตมีค่าเป็นบวกเล็กน้อย ($v_{GS} > 0$) โอลจะถูกผลักออกจากบริเวณข้างบน ทำให้เกิด “บริเวณปลอดพาหะ (depletion region)” ขึ้นได้ชั้นออกไซด์

ถ้าเราให้แรงดันที่เกตมีค่าเป็นบวกเพิ่มสูงขึ้นถึงแรงดันขีดเริ่มเปลี่ยน (threshold voltage: V_{tn}) แล้ว สนามไฟฟ้าที่ตกคร่อมชั้นออกไซด์จะดึงดูดอิเล็กตรอนอิสระที่เป็นพาหะส่วนน้อยในบริเวณขาขอดีขึ้นมาทำให้เกิด “ชั้นผ้นแปร (inversion layer)” ชนิด N ขึ้นใช้ชั้นออกไซด์ ทั้งนี้ชั้นผ้นแปรจะเสมือนเป็น “ช่องนำกระแส (channel)” เชื่อมต่อระหว่างบริเวณเดรนและซอร์ส ภายใต้เงื่อนไข $v_{GS} = v_{GD} > V_{tn}$ โดยความต้านทานของช่องนำกระแส ($R_{channel}$) มีค่าแปรผกผันกับความหนาแน่นของอิเล็กตรอนอิสระภายในช่องนำกระแสและแปรผันโดยตรงกับแรงดัน

$$V_{eff} = v_{GS} - V_{tn}$$

หลังจากเกิดช่องนำกระแสระหว่างชาเดรนกับชาซอร์สแล้ว หากเราป้อนแรงดัน v_{DS} ระหว่างชาเดรนและซอร์สจะทำให้เกิดกระแสไหลจากชาเดรนไปยังชาซอร์สได้ค่าเท่ากับ $i_{DS} = v_{DS} / R_{channel}$ นั้นแสดงว่า ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าประเภท NMOS นี้จะทำตัวเสมือนเป็นตัวต้านทานที่ถูกควบคุมด้วยแรงดันไฟฟ้า หรือหากพิจารณาในรูปกระแสอาจกล่าวได้ว่า ทรานซิสเตอร์นี้ใช้สนามไฟฟ้าที่ตกคร่อมชั้นออกไซด์ในการควบคุมกระแส เราจึงเรียกทรานซิสเตอร์นี้ว่าเป็น “ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า”

กรณีทรานซิสเตอร์ชนิด PMOS

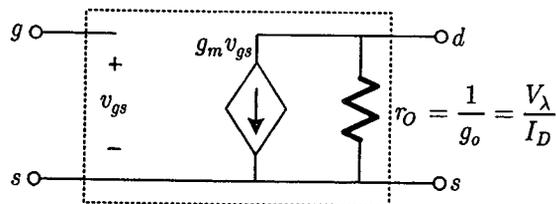
การอธิบายการทำงานของทรานซิสเตอร์ไฟฟ้าประเภท PMOS สามารถอธิบายเช่นเดียวกับ NMOS แต่มีแรงดันขีดเริ่มเปลี่ยนเป็น V_{tp} น้อยกว่าศูนย์ ($V_{tp} < 0$) และ

$$V_{eff} = v_{SG} - |V_{tp}|$$

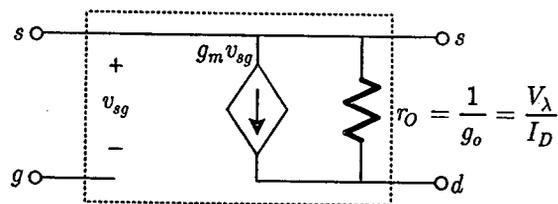
สถานะ	เงื่อนไข	ช่องนำกระแส
คัตออฟ	$v_{SG} < V_{tp} $ หรือ $V_{eff} < 0$	ไม่มี
ไตรโอด	$v_{SG} > V_{tp} $ และ $v_{SD} < V_{eff}$ หรือ $V_{eff} > v_{SD} > 0$	ต่อเนื่องระหว่างเดรนและซอร์ส
แอกทีฟ	$v_{SG} > V_{tp} $ และ $v_{SD} > V_{eff}$ หรือ $v_{SD} > V_{eff} > 0$	ถูกตัดขาด ณ จุดใกล้ซอร์ส

ข) แบบจำลองสัญญาณขนาดเล็ก

การวิเคราะห์วงจรขยายสัญญาณที่ใช้ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า จะใช้การวิเคราะห์โดยอาศัยแบบจำลองสัญญาณขนาดเล็ก (small-signal model) ของทรานซิสเตอร์ เพราะสามารถใช้ทฤษฎีวงจรร่วมไฟฟ้าช่วยวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้



(ก)



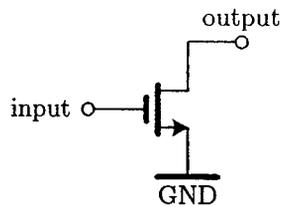
(ข)

ภาพที่ 19 แบบจำลองสัญญาณขนาดเล็กของทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าที่รวมผลของการแปรผันความยาวช่องกระแส กรณี (ก) NMOS และ (ข) PMOS

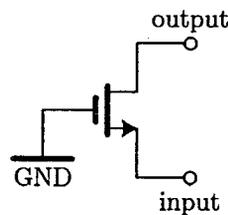
จากภาพที่ 19 เป็นแบบจำลอง อนุ ความถี่ต่ำประกอบด้วยแหล่งจ่ายกระแสค่าเท่ากับ $g_m v_{gs}$ ซึ่งถูกควบคุมด้วยแรงดันระหว่างขาคัทและชาซอร์ส (v_{gs}) และความต้านทานทางเอาต์พุตซึ่งต่อขนานระหว่างขาคัทและชาซอร์ส r_o มีค่าเท่ากับ $1/g_o = V_\lambda / I_D$

ค) การนำทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้าไปใช้งานเป็นวงจรรขยายสัญญาณ

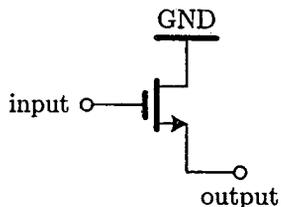
การใช้ทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้าไปใช้ในการขยายสัญญาณ เราสามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะคือ วงจรรขยายแบบซอร์สร่วม (common source) วงจรรขยายแบบเกทร่วม (common gate) และวงจรรขยายแบบเดรนร่วม (common drain) ซึ่งวงจรรขยายแต่ละแบบแสดงได้ดังภาพที่ 20 (แสดงเฉพาะโครงสร้าง)



(ก)



(ข)



(ค)

ภาพที่ 20 ลักษณะของวงจรรขยายสัญญาณแบบพื้นฐานที่ใช้ทรานซิสเตอร์แบบสนามไฟฟ้า
(ก) วงจรรขยายแบบซอร์สร่วม (ข) วงจรรขยายแบบเกทร่วม และ (ค) วงจรรขยายแบบเดรนร่วม

โดยภาพที่ 20(ก) เป็นวงจรรขยายสัญญาณที่มีลักษณะเด่นคือ อัตรารขยายมีค่าสูง และเกิดการกลับเฟสกันระหว่างสัญญาณทางเอาต์พุตกับสัญญาณอินพุต มีความต้านทานขาเข้าสามารถกำหนดจากความต้านทานภายนอกที่ต่อเข้าที่ขาเกต ส่วนความต้านทานขาออกมีค่าเท่ากับความต้านทาน r_o ขนานกับความต้านทานภายนอกที่ต่อที่ขาเดรน

ภาพที่ 20(ข) เป็นวงจรรขยายสัญญาณที่มีลักษณะเด่นคือ สัญญาณอินพุตและเอาต์พุตมีเฟสเดียวกัน มีอัตรารขยายสัญญาณค่อนข้างต่ำ เนื่องจากความต้านทานขาเข้ามีค่าต่ำ ส่วนความต้านทานขาออกมีค่าเท่ากับความต้านทานภายนอกที่ต่อเข้าที่ขาเดรนของทรานซิสเตอร์

ส่วนภาพที่ 20(ค) เป็นวงจรรขยายสัญญาณที่มีลักษณะเด่นคือ อัตรารขยายมีค่าใกล้เคียง 1 มีความต้านทานขาเข้าสูงกำหนดได้จากความต้านทานภายนอกซึ่งต่อเข้าที่ขาเกต ส่วนความต้านทานขาออกมีค่าต่ำ ด้วยเหตุนี้ เราจึงนำไปใช้เป็นวงจรรบัพเฟอร์ (buffer amplifier หรือบางครั้งเรียกว่า วงจรกันชน)

4. กล่าวสรุป

ในบทนี้ เราได้ทราบวิธีการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น ทีละขั้นตอนแบบ step-by-step พร้อมรูปภาพประกอบซึ่งได้ช่วยให้ผู้อ่านสามารถทำตามได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งได้ทราบการเรียกใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ เรายังได้อธิบายทฤษฎีพื้นฐานที่สำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญเช่น ไดโอด ออปแอมป์ ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์และแบบสนามไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ศึกษาในรายประเด็นที่สำคัญ โดยเฉพาะคุณสมบัติทางไฟตรงและไฟสลับ รวมไปถึงลักษณะการนำไปใช้งานในรายงานฉบับนี้ด้วย